# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07-050197

(43) Date of publication of application: 21.02.1995

------

(51) Int.CI. H05B 33/22

(21) Application number: 05-327981

(71) Applicant: WESTAIM TECHNOL INC

(22) Date of filing: 24.12.1993

(72) Inventor: WU XINGWEI, STILES JAMES A R

FOO KEN K, BAILEY PHILLIP

-----

#### (30) Priority

Priority number: 92 996547, 93 52702 Priority date: 24.12.1992, 30.04.1993

Priority country: US, US

.....

(54) EL LAMINATED DIELECTRIC LAYER STRUCTURE BODY, METHOD FOR FORMATION THEREOF, METHOD FOR DRAWING PATTERN BY LASER, AND DISPLAY PANEL

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To evenly apply voltage to a phosphor layer and improve the electroluminescence efficiency by combining a thick dielectric layer having a prescribed dielectric strength and a specified high dielectric constant with a thin phosphor layer with a low dielectric constant.

CONSTITUTION: Back side electrodes 14 are arranged in a substrate, a thick dielectric layer 18 and a thin dielectric layer 20 are formed on the electrodes, and then a phosphor layer 22 and a transmissive front side electrode layer 24 are successively formed. The dielectric layers 18, 20 are flat ceramic layers and have dielectric strength 1.0×106 V/m or higher dielectric constant ratio to a phosphor 50:1 or more, and the thickness ratio to that of the phosphor layer 22 within a range from (20:1) to (500:1). With such a structure, the electroluminescent(EL) laminated layers have different dielectric constants and the interlayer potential difference is proportional to the thickness of each layer and inversely proportional to the relative dielectric constants of the materials for respective materials and utilizing these properties and dispersive property, voltage flowing in pixels before electricity application to the phosphor layer can be applied to the whole body of the phosphor layer and the electroluminescence efficiency is thus improved.

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平7-50197

(43)公開日 平成7年(1995)2月21日

(51) Int.Cl.6

散別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/22

#### 審査請求 未請求 請求項の数92 OL (全 26 頁)

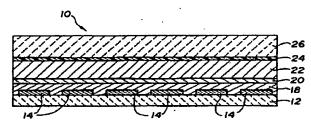
(21)出願番号	特願平5-327981	(71)出願人	593232527
			ウェステイム テクノロジーズ インコー
(22)出顧日	平成5年(1993)12月24日		ポレイテッド
			カナダ国 アルバータ フォート サスカ
(31)優先権主張番号	07/996547		ッチュワン ボックス 1000
(32)優先日	1992年12月24日	(72)発明者	シンウェイ ウー
(33)優先権主張国	米国 (US)		カナダ国 アルバータ エドモントン
(31)優先権主張番号	08/052702		14504-37 ストリート (番地なし)
(32)優先日	1993年4月30日	(72)発明者	ジェイムズ アレクサンダー ロパート
(33)優先権主張国	米国 (US)		スタイルズ
•			カナダ国 アルバータ エドモントン
			12719-39 アヴェニュー (番地なし)
	•	(74)代理人	弁理士 矢野 敏雄 (外2名)
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 ELラミネート誘電層構造体および該誘電層構造体生成方法ならびにレーザパターン描画方法およびディスプレイパネル

#### (57)【要約】

【目的】 エレクトロルミネセンスラミネートの誘電層 を改善する。

【構成】 誘電層は厚膜層としてセラミック材料から生成される。この場合、約1.0×10<sup>6</sup> V/mの絶縁耐力と、誘電材料の誘電率と燐光層の誘電率との比が約50:1よりも大きくなるような誘電率を有する。また、誘電層の厚さと燐光層の厚さの比が約20:1~500:1の範囲内になるような厚さを有する。さらに、燐光層と両立性があり、この燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光するのに十分に滑らかである、燐光層と隣接する表面を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 前面電極と背面電極との間に挟まれた燐 光層を有し、前記背面電極は基板上に形成されており、 前記燐光層は誘電層により背面電極から分離されている 形式の、ELラミネート誘電層構造体において、

セラミック材料により生成された平坦な層を有しており、該層は、約1.0×10<sup>6</sup> V/mよりも大きい絶縁耐力と誘電材料の誘電率と燐光体の誘電率の比が50:1よりも大きくなるような誘電率を有しており、

前記誘電層は、当該誘電層の厚さと前記燐光層の厚さの 10 比が約 $20:1\sim500:1$  の範囲内になるような厚さを有し、

該誘電層は、前記燐光層と両立性があり該燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光するのに十分に滑らかである、前記燐光層に隣接する平面を有することを特徴とする、ELラミネート誘電層構造体。

【請求項2】 誘電材料の誘電率と燐光材料の誘電率との比は約100:1よりも大きく、前記誘電層は、当該誘電層の厚さと燐光層の厚さとの比が約40:1~300:1の範囲内になるような厚さを有する、請求項1記 20 載の誘電層構造体。

【請求項3】 透過性の前面電極と背面電極との間に挟まれており、前記誘電層により背面電極と分離されている薄膜燐光層を有する形式のエレクトロルミネセンスラミネート中に設けられている、請求項1記載の誘電層構造体。

【請求項4】 約500よりも大きい誘電率と約10~300ミクロンの範囲内の厚さを有する、請求項3記載の誘電層構造体。

【請求項5】 少なくとも2つの層により形成されており、第1の誘電層は背面電極上に生成されており、請求項4記載の絶縁耐力と誘電率の値を有し、第2の誘電層は第1の誘電層上に生成されており、請求項1記載の燐光層に隣接した平面を有し、前記の第1および第2の誘電層は合わせて請求項4記載の厚さを有する、請求項4記載の誘電層構造体。

【請求項6】 前記の第1および第2の誘電層は強誘電性セラミック材料から成る、請求項5記載の誘電層構造体。

【請求項7】 前記第2の誘電層は、少なくとも20の 誘電率と少なくとも約2ミクロンの厚さを有する、請求 項5記載の誘電層構造体。

【請求項8】 前記の第1の誘電層は少なくとも100 0の誘電率を有し、前記第2の誘電層は少なくとも10 0の誘電率を有する、請求項7記載の誘電層構造体。

【請求項9】 前記第1の誘電層は約20~150ミクロンの範囲内の厚さを有し、前記第2の誘電層は約2~10ミクロンの範囲内の厚さを有する、請求項8記載の誘電層構造体。

【調求項10】 前記の第1および第2の誘電層は、ペ 50 生成する方法において、

ロブスカイト結晶構造を有する強誘電性のセラミック材料により生成されている、請求項9記載の誘電層構造体。

【請求項11】 前記第1の誘電層は、厚膜技術およびこれに続く背面電極の融点よりも低い温度での焼結により生成される、請求項5、6または10記載の誘電層構造体。

【請求項12】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷により生成される、請求項11記載の誘電層構造体。

【請求項13】 前記第2の誘電層は、ゾル・ゲル技術での生成およびこれに続く背面電極の融点よりも低い温度での焼結により生成される、請求項11記載の誘電層構造体。

【請求項14】 前記第2の誘電層は、スピンディポジションまたは浸せきを含むゾル・ゲル技術およびこれに 続く背面電極の融点よりも低い温度での焼結により生成 される、請求項12記載の誘電層構造体。

【請求項15】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成り、前記第2の誘電層はジルコル酸ーチタン酸鉛またはランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項5、6または10記載の誘電層構造体。

【請求項16】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛またはランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項11記載の誘電層構造体。

【請求項17】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛またはランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項14記載の誘電層構造体。

【請求項18】 焼結温度に耐え得る基板上に生成された背面電極を有するラミネート中に設けられている、請求項14記載の誘電層構造体。

【請求項19】 前記基板はアルミナである、請求項1 8記載の誘電層構造体。

【請求項20】 燐光層に隣接する誘電層の表面は、約1000ミクロンよりも大きく約0.5ミクロンより大きく異ならない表面起伏を有する、請求項4、5または14記載の誘電層構造体。

【請求項21】 アルミナ基板上の銀/プラチナのアド 40 レス線路から成る背面電極とインジウムスズ酸化物のアドレス線路から成る前面電極とを有するラミネート中に 設けられている、請求項17記載の誘電層構造体。

【請求項22】 前面電極上部にシール層を有するラミネート中に設けられている、請求項21記載の誘電層構造体。

【請求項23】 前面電極と背面電極との間に挟まれた 燐光層を有し、前記背面電極は基板上に生成され、前記 燐光層は誘電層により背面電極と分離されている形式の エレクトロルミネセンスラミネート中の誘電層構造体を 生成する大法にないて

-2-

2

約1.0×106 V/mよりも大きい絶縁耐力と、誘電 層の厚さと燐光層の厚さとの比が約20:1~500: 1の範囲内になるような厚さを有する誘電層を生成する ために、誘電材料の誘電率と燐光材料の誘電率の比が約 50:1よりも大きくなるような誘電率を有するセラミ ック材料を、厚膜技術およびこれに続く焼結により背面 電極上にディポジットし、

当該誘電層は、エレクトロルミネセンス層と両立性があ り前記燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光す るのに十分に滑らかである、前記燐光層と隣接する平面 10 を生成することを特徴とする、誘電層を生成する方法。

【請求項24】 誘電材料の誘電率と燐光材料の誘電率 との比は約100:1よりも大きく、誘電層の厚さと燐 光層の厚さとの比は約40:1~300:1の範囲内で ある、請求項23記載の方法。

【請求項25】 前記誘電層は、透過性の前面電極と背 面電極との間に挟まれており当該誘電層により背面電極 と分離されている薄膜燐光層を有する形式のエレクトロ ルミネセンスラミネート中に生成される、請求項23記 戯の方法。

【請求項26】 セラミック材料の誘電率は約500よ りも大きく、誘電層の厚さは約10~300ミクロンの 範囲内にある、請求項25記載の方法。

【請求項27】 前記誘電層は少なくとも2つの層とし て形成され、第1の誘電層は厚膜技術で背面電極上にデ ィポジットされ請求項26記載の絶縁耐力と誘電率の値 を有し、第2の誘電層は、請求項23記載の燐光層と隣 接する面を形成するために第1の誘電層上にディポジッ トされ、第1および第2の誘電層は合わさって請求項2 6記載の厚さを有する、請求項26記載の方法。

【請求項28】 前記の第1および第2の誘電層は、強 誘電性セラミック材料により生成される、請求項27記 載の方法。

【請求項29】 前記第2の誘電層は少なくとも20の 誘電率と少なくとも約2ミクロンの厚さを有する、請求 項27配載の方法。

【請求項30】 前記第1の誘電層は少なくとも100 0の誘電率を有し、前記第2の誘電層は少なくとも10 0の誘電率を有する、請求項29記載の方法。

【請求項31】 前記第1の誘電層は約20~150ミ クロンの範囲内の厚さを有し、前記第2の誘電層は約2 ~10ミクロンの範囲内の厚さを有する、請求項30記 載の誘電層。

【請求項32】 前記の第1および第2の誘電層は、ペ ロプスカイト結晶構造を有する強誘電性セラミック材料 により生成される、請求項31記載の誘電層。

【請求項33】 前記第1の誘電層は厚膜技術でディポ ジットされ、次に背面電極の融点よりも低い温度で焼結 される、請求項27、28または32記載の方法。

ディポジットされる、請求項33記載の方法。

【請求項35】 前記第2の誘電層はゾル・ゲル技術で ディポジットされ、次に背面電極の融点よりも低い温度 で焼結される、請求項33記載の方法。

【請求項36】 前記第2の誘電層は、スピンディポジ ションまたは浸せきを含むゾル・ゲル技術でディポジッ トされ、次に背面電極の融点よりも低い温度で焼結され る、請求項34記載の方法。

【請求項37】 第1の誘電層はニオブ酸鉛により生成 され、第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛またはラ ンタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛により生成される、 請求項27、28または32記載の方法。

【請求項38】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛により 生成され、前記第2の誘電層はジルコル酸ーチタン酸鉛 またはランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛により生成 される、請求項33記載の方法。

【請求項39】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛により 生成され、前記第2の誘電層はジルコル酸-チタン酸鉛 またはランタン酸ージルコル酸ーチタン酸鉛により生成 される、請求項36記載の方法。

【請求項40】 前記誘電層は、焼結温度に耐え得る基 板上に生成された背面電極を有するラミネート中に生成 される、請求項36記載の方法。

【請求項41】 前記基板はアルミナである、請求項4 0 記載の方法。

【請求項42】 燐光層に隣接する前記誘電層の面は、 約1000ミクロンよりも大きく約0.5ミクロンより 大きく異ならない表面起伏を有する、請求項26、27 または36記載の方法。

【請求項43】 前記誘電層は、アルミナ基板上の銀/ 30 プラチナのアドレス線路で形成された背面電極と、イン ジウムスズ酸化物のアドレス線路で形成された前面電極 とを有するラミネート中に生成される、請求項39記載 の方法。

【請求項44】 前記誘電層は、前面電極上部にシール 層を有するラミネート中に生成される、請求項39記載 の方法。

【請求項45】 平坦なエレクトロルミネセンスラミネ ートから電圧駆動回路への電気接続を行なわせるエレク 40 トロルミネセンスディスプレイパネルにおいて、

交差するアドレス線路の前面のセットと背面のセットと の間に挟まれた燐光層が設けられており、前記背面アド レス線路は基板上に形成されており、前記燐光層は誘電 層により背面アドレス線路から、および必要に応じて前 面アドレス線路から分離されており、

前記基板は複数個のスルーホールを形成し、

各アドレス線路を電圧駆動回路と接続するために、基板 中のスルーホールの各々を貫通してアドレス線路の各々 へ至る導体路を成す手段が設けられていることを特徴と 【請求項34】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷で 50 する、エレクトロルミネセンスディスプレイパネル。

【請求項46】 前記電圧駆動回路は電圧駆動コンポー ネントを有しており、該コンポーネントの出力側はスル ーホールを介してアドレス線路と接続されており、前記 コンポーネントは基板の背面上に取り付けられている、 請求項45記載のディスプレイパネル。

【請求項47】 導体路を成す前記の手段は、スルーホ ールの各々にディポジットされ基板の各側上に前面コネ クタ路と背面コネクタ路とを形成する導電性部材と、前 記の前面コネクタ路とアドレス線路の各々との間に設け られた導電性部材とを有する、請求項46記載のディス プレイパネル。

【請求項48】 前記基板は、約850° Cの温度に耐 え得る材料から成る、請求項47記載のディスプレイパ

【請求項49】 前記基板は不透明である、請求項48 記載のディスプレイパネル。

【請求項50】 前記基板はアルミナである、請求項4 8記載のディスプレイパネル。

【請求項51】 前記基板は概して方形であり、前記ス ルーホールは、少なくとも2つの側においてアドレス線 20 路端部に隣接する基板の周囲に形成されている、請求項 47記載のディスプレイパネル。

【請求項52】 前記の導電性部材は焼成された厚膜ペ ーストである、請求項51記載のディスプレイパネル。

【請求項53】 背面アドレス線路へ至る導電性部材は 銀/プラチナであり、前面アドレス線路へ至る導電性部 材は銀である、請求項52記載のディスプレイパネル。

【請求項54】 スルーホールの各々を貫通する導体路 を成す前記の手段は、基板背面上に1つの回路パーター ンで印刷され、前面導体路と背面導体路とを形成するた 30 めに基板中のホールを貫通して引き出される第1の焼成 された厚膜導電性ペーストと、前面コネクタ路とアドレ ス線路との間に設けられた第2の焼成された導電性ペー ストとを有する、請求項46記載のディスプレイパネ ル。

【請求項55】 電圧駆動回路は電圧駆動コンポーネン トを有しており、前記回路パターンによりさらに、電圧 駆動コンポーネントの出力側の電気接続用コネクタ路と 駆動回路へ至るコネクタ路が形成される、 請求項54記 戟のディスプレイパネル。

【請求項56】 前記基板は概して方形であり、前記ス ルーホールは、少なくとも2つの側でアドレス線路端部 と隣接する基板の周囲に形成されている、請求項55記 載のディスプレイパネル。

【請求項57】 前記第1の厚膜ペーストは銀プラチナ ペーストであり、前記第2の厚膜ペーストは銀ペースト である、請求項56記載のディスプレイパネル。

【請求項58】 誘電層はセラミック材料から成る平坦 な層を有しており、該層は、約1.0×106 V/mよ 電率との比が約50:1よりも大きくなるような誘電率 を有し、前記誘電層は、当該誘電層の厚さと燐光層の厚 さとの比が約20:1~500:1の範囲内になるよう な厚さを有し、かつ当該誘電層は、燐光層と両立性があ り該燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光する のに十分に滑らかである、燐光層と隣接した面を有す る、請求項54記載のディスプレイパネル。

【請求項59】 前記誘電層は少なくとも2つの層から 成り、第1の誘電層は背面電極上に生成されており、約 500よりも大きい誘電率と10~300ミクロンの節 囲内の厚さを有し、第2の誘電層は第1の誘電層上に生 成されており、請求項58記載の燐光層と隣接する面を 有しており、前記の第1および第2の誘電層は合わせて 約10~300ミクロンの厚さを有する、請求項58記 載のディスプレイパネル。

【請求項60】 前記の第1および第2の誘電層は、ペ ロブスカイト結晶構造を有する強誘電性セラミック材料 から成り、前記第1の誘電層は少なくとも1000の誘 電率と約20~150ミクロンの厚さを有し、前記第2 の誘電層は少なくとも100の誘電率と2~10ミクロ ンの厚さを有する、請求項59記載のディスプレイパネ

【請求項61】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷と 厚膜誘電ペーストの焼結により生成され、前記第2の誘 電層はゾル・ゲル技術とこれに続く焼成により生成され る、請求項60記載のディスプレイパネル。

【請求項62】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成 り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛または ランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項 61記載のディスプレイパネル。

【請求項63】 少なくとも1つのオーバーレイ層と少 なくとも1つのアンダーレイ層とを有する平坦なラミネ ートにパターンをレーザ描画する方法において、

フォーカシングされたレーザビームをラミネートのオー バーレイ層側に印加し、アンダーレイ層の少なくとも一 部分は直接的に除去されるが、オーバーレイ層は間接的 にその厚さ方向全体で除去されるように、前記レーザビ ムは、オーバーレイ層により実質的に吸収されないが アンダーレイ層により吸収される波長を有することを特 40 徴とする、平坦なラミネートにパターンをレーザ描画す る方法。

【請求項64】 前記オーバーレイ層は可視光に対し透 過性であり、前記アンダーレイ層は可視光に対し非透過 性であり、前記レーザビームの波長は電磁スペクトルの 可視または赤外線領域にある、請求項63記載の方法。

【請求項65】 前記の層の組成および厚さは、

 $\Sigma$ i  $\alpha$ vi Tvi >  $\Sigma$ i  $\alpha$ vi Tvi

であり、ここにおいて、αυ はアンダーレイ層の吸収 率、αo はオーバーレイ層の吸収率、Tu はアンダーレ りも大きい絶縁耐力と、誘電材料の誘電率と燐光体の誘 50 イ層の厚さ、T。はオーバーレイ層の厚さである、請求 7

項63記載の方法。

【請求項66】 前記の層は、オーバーレイ層はアンダ ーレイ層よりも低い温度で気化されるようにして構成さ れている、請求項65記載の方法。

【請求項67】 前記の層は、オーバーレイ層はアンダ ーレイ層よりも高い熱伝導性を有するよう構成されてい る、請求項66記載の方法。

【請求項68】 前記オーバーレイ層は透過性の導電性 部材であり、該部材へ電極パターンが描画される、請求 項63記載の方法。

【請求項69】 前記の電極パターンは、ラミネートと レーザビームのうちの一方または両方を互いに相対的に 移動させることにより生成される、請求項68記載の方

【請求項70】 前記ラミネートは、透過性導電部材と 燐光体のオーバーレイ層と、1つまたは複数個の誘電層 のアンダーレイ層とを有するELラミネートであり、前 記電極パターンは、透過性導電部材の互いに平行に間隔 をおいて配置された複数個のアドレス線路から成る、請 求項69記載の方法。

【請求項71】 前記誘電層の一部分は直接的に除去さ れ、前記の燐光体および透過性導電部材はそれらの厚さ 全体にわたって間接的に除去される、請求項70記載の 方法。

【請求項72】 前記の透過性導電部材はインジウムス ズ酸化物である、請求項71記載の方法。

【請求項73】 前記誘電層は、セラミック材料により 生成された平坦な層を有しており、該層は、約1.0× 10<sup>6</sup> V/mよりも大きい絶縁耐力と、誘電材料の誘電 率と燐光体の誘電率との比が約50:1よりも大きくな るような誘電率を有しており、前記誘電層は、該誘電層 の厚さと燐光層との厚さの比が約20:1~500:1 の範囲内になるような厚さを有しており、該誘電層は、 前記燐光層と両立性があり該燐光層が所定の励起電圧で 全体的に均一に発光するのに十分に滑らかである該燐光 層に隣接した表面を有する、請求項72記載の方法。

【請求項74】 前記誘電層は少なくとも2つの層から 成り、第1の誘電層は背面電極上に生成され、約500 よりも大きい誘電率と約10~300ミクロンの範囲内 の厚さを有しており、第2の誘電層は前記第1の誘電層 上に生成され、請求項73記載の燐光層に隣接する表面 を有しており、前記の第1および第2の誘電層は合わせ で約10~300ミクロンの厚さを有する、請求項73 記載の方法。

【請求項75】 前記の第1および第2の誘電層は、ペ ロプスカイト結晶構造を有する強誘電性のセラミック材 料により生成され、前記第1の誘電層は、少なくとも1 000の誘電率と約20~150ミクロンの厚さを有 し、前記第2の誘電層は、少なくとも100の誘電率と

方法。

【請求項76】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷お よび厚膜誘電ペーストの焼結により生成され、第2の誘 電層はゾル・ゲル技術およびこれに続く焼成により生成 される、請求項75記載の方法。

8

【請求項77】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成 り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛または ランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項 76記載の方法。

10 【請求項78】 交差するアドレス線路の前面のセット および背面のセットの間に挟まれた燐光層を有し、前記 背面アドレス線路は基板上に形成され、前記燐光層は誘 電層により背面アドレス線路から、および必要に応じて 前面アドレス線路から分離されている形式のELラミネ ートを生成する方法において、

- a) 基板上に背面アドレス線路を形成し、
- b) 該背面アドレス線路上に誘電層を生成し、
- c) 該誘電層上に燐光層を生成し、
- d) 必要に応じて該燐光相乗に透過性誘電層を生成し、
- e)アンダーレイ層上に透過性導電部材の層をディポジ 20 ットすることにより、アンダーレイ燐光層または透過性 誘電層上に前面アドレス線路を形成し、フォーカシング されたレーザビームにより該アンダーレイ層にアドレス 線路を描画し、アンダーレイ誘電層の一部分がレーザビ ームにより直接的に除去され、オーバーレイ燐光層およ び必要に応じて透過性誘電体ならびに透過性導電部材が それらの厚さ全体にわたり間接的に除去されるように、 前記レーザービームは、透過性導電部材、透過性誘電層 および燐光層により実質的に吸収されないがアンダーレ 30 イ誘電層により吸収される波長を有することを特徴とす る、ELラミネートを生成する方法。

【請求項79】 前記レーザビームは約400nmより も大きい波長を有する、請求項78記載の方法。

【請求項80】 前記の層の組成および厚さは、

 $\Sigma$ i  $\alpha$ ui Tui  $> \Sigma$ i  $\alpha$ oi Toi

であり、ここにおいて、αυ はアンダーレイ誘電層の吸 収率、α。は透過性の層の吸収率、Tuはアンダーレイ 誘電層の厚さ、T。は透過性の層の厚さである、請求項 79記載の方法。

【請求項81】 前記透過性導電部材は酸化インジウム 40 スズである、請求項80記載の方法。

【請求項82】 燐光層をアンダーレイする誘電層はセ ラミック材料から成る平坦な層を有しており、該層は、 約1. 0×106 V/mよりも大きい絶縁耐力と、誘電 材料の誘電率と燐光体の誘電率との比が約50:1より も大きくなるような誘電率を有しており、前記誘電層 は、該誘電層の厚さと燐光層との厚さの比が約20:1 ~500:1の範囲内になるような厚さを有しており、 該誘電層は、前記燐光層と両立性があり該燐光層が所定 約2~10ミクロンの厚さを有する、請求項74記載の 50 の励起電圧で全体的に均一に発光するのに十分に滑らか

である該燐光層に隣接した表面を有する、 請求項81記 載の方法。

【請求項83】 前記誘電層は少なくとも2つの層から成り、第1の誘電層は背面電極上に生成され、約500よりも大きい誘電率と約10~300ミクロンの範囲内の厚さを有し、第2の誘電層は前記第1の誘電層上に生成され、請求項82記載の燐光層に隣り合う表面を有しており、前記の第1および第2の誘電層は合わせて約10~300ミクロンの厚さを有する、請求項82記載の方法。

【請求項84】 第1および第2の誘電層はペロブスカイト結晶構造を有する強誘電性セラミック材料から成り、第1の誘電層は少なくとも100の誘電率と約20~150の厚さを有し、前記第2の誘電層は少なくとも100の誘電率と約2~10ミクロンの厚さを有する、請求項83記載の方法。

【請求項85】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷と 厚膜誘電ペーストの焼結により生成され、前記第2の誘 電層はゾル・ゲル技術およびこれに続く焼成により生成 される、請求項84記載の方法。

【請求項86】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛またはランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項85記載の方法。

【請求項87】 ELラミネートにおいて、 背面基板と、

該背面基板上に互いに平行に間隔をおいて配置されたア ドレス線路の背面セットと、

背面アドレス線路上の誘電層と該誘電層上の燐光層と、 該燐光層上に必要に応じて設けられる透過性誘電層と、 前記燐光層上部に互いに平行に間隔をおいて配置された アドレス線路の前面の透過性のセットとを有し、

前記アドレス線路は、交差点でピクセルが形成されるように背面アドレス線路と交差しており、前記前面アドレス線路は、レーザで描画されたみぞにより分離されており、該みぞは、アンダーレイ燐光層を貫通してアンダーレイ誘電層へこれを貫通せずに延在していることを特徴とするELラミネート。

【請求項8.8】 前記の背面アドレス線路上の誘電層はセラミック材料から成る平坦な層を有しており、該層は、約1.0×10<sup>6</sup> V/mよりも大きい絶縁耐力と、誘電材料の誘電率と燐光体の誘電率との比が約50:1よりも大きくなるような誘電率を有しており、前記誘電層は、該誘電層の厚さと燐光層との厚さの比が約20:1~500:1の範囲内になるような厚さを有しており、該誘電層は、前記燐光層と両立性があり該燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光するのに十分に滑らかである該燐光層に隣接した表面を有する、請求項87記載のELラミネート。

【請求項89】 前記誘電層は少なくとも2つの層から

10

成り、第1の誘電層は背面電極上に生成され、約500 よりも大きい誘電率と約10~300ミクロンの範囲内 の厚さを有し、第2の誘電層は前記第1の誘電層上に生 成され、請求項88記載の燐光層に隣り合う表面を有し ており、前記の第1および第2の誘電層は合わせて約1 0~300ミクロンの厚さを有する、請求項88記載の ELラミネート。

【請求項90】 前記の第1および第2の誘電層はペロプスカイト結晶構造を有する強誘電性セラミック材料から成り、第1の誘電層は少なくとも100の誘電率と約20~150の厚さを有し、前記第2の誘電層は少なくとも100の誘電率と約2~10ミクロンの厚さを有する、請求項89記載のELラミネート。

【請求項91】 前記第1の誘電層はスクリーン印刷と 厚膜誘電ペーストの焼結により生成され、前記第2の誘 電層はゾル・ゲル技術およびこれに続く焼成により生成 される、請求項90記載のELラミネート。

【請求項92】 前記第1の誘電層はニオブ酸鉛から成り、前記第2の誘電層はジルコン酸ーチタン酸鉛または ランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛から成る、請求項 91記載のELラミネート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エレクトロルミネセンスラミネートおよびエレクトロルミネセンスラミネートの製造方法に関する。本発明はまた、エレクトロルミネセンスラミネートから電圧駆動回路への電気接続を行うエレクトロルミネセンスディスプレイパネルに関する。本発明はさらに、扁平ラミネートにパターンを刻みつけるレーザに関する。前記パターンは例えば、エレクトロルミネセンスラミネートの透明電極のアドレス線である。

[0002]

【従来の技術】エレクトロルミネセンス(EL)は、電界を適用したことによる蛍光体からの光の放出である。エレクトロルミネセンス案子はランプまたはディスプレイとして有用である。最近、エレクトロルミネセンス案子は扁平パネルディスプレイ案子に使用される。この案子は所定の特徴的形状または個別にアドレッシング可能40 なピクセルを矩形マトリックスに有する。

【0003】エレクトロルミネセンスの先駆的研究は、GTESylvaniaで行われた。交流電圧がパウダーまたは散乱形EL素子に供給される。この素子では、光放出蛍光体パウダーが有機接着剤に埋め込まれており、これがガラス基板上にデポジットされていて、透明電極により覆われている。これらのパウダーまたは散乱形EL素子は一般的に低輝度であり、広範囲の適用を妨げる欠点がある。

【0004】 薄膜エレクトロルミネセンス (TFEL) 50 案子は1950年代に開発された。交流薄膜ELラミネ ートの基本構造は良く知られており、例えばTornqvist, R. O. 著、"Thin-Film Electroluminescent Displays", Society for InformationDisplay, 1989, International Symposium Seminar Lecture Notesおよび米国特許4857802号明細書に記載されている。蛍光層は電極ペアの間にサンドウィッチされており、電極からそれぞれ絶縁/誘電層により分離されている。最も一般的には、蛍光材料はアクティベータ(ドーパント)としてMnを含むZnSである。ZnS:MnTFELは黄色発光である。他の色の蛍光体が開発された。

【0005】従来のTFELラミネートの膜は基板、通常はガラスにデポジットされている。膜のデポジットは 実質的に公知の薄膜技術、例えば電子ビーム真空蒸着またはスパッタリングによって行われる。最近は原子膜エピタクシー(ALE)により行われる。TFELラミネート全体の厚さはわずか1または2ミクロンのオーダである。

【0006】蛍光層を電極から分離および電気絶縁する ために、種々の絶縁/誘電材料が公知であり、後で詳細 に説明するように使用される。

【0007】2つの電極はそれぞれ、それが案子の(見る方向で) "後"側または"前"側にあるかに依存して異なる。例えばアルミニウムのような反射材料が典型的に後側電極に使用される。比較的に薄く光学的に透明のインジウムすず酸化物(ITO)が典型的に、前側電極に使用される。ランプに適用する場合、2つの電極は連続膜の形態をとり、これにより蛍光層全体は電極間で電界にさらされる。典型的なディスプレイ適用例では、前側電極および後側電極は、行電極および列電極を定める導電アドレス線により適切にパターン化されている。行電極と列電極が重なるところにピクセルが定められる。1つの行電極と1つの列電極に同時に電圧を印加することにより個々のピクセルをアドレシングする種々の電子ディスプレイ案子が公知である。

【0008】概念は簡単であるけれども、薄膜エレクトロルミネセンス素子の開発には多数の実際上の困難がある。第1の困難は、案子が薄膜技術によりデポジットされた個々のラミネートから形成されることである。膜での非常に小さな欠陥も故障の原因となり得る。第2にこれらの薄膜素子は典型的には相対的に高電圧(例えばピークピークで300~450V)で動作されることである。実際この電圧は蛍光層をその絶縁破壊電圧を越えて、それを導通させて、動作させるほどである。蛍光層の両側の薄膜骸電層は電極間の導電を制限または阻止することが要求される。大きな電界の適用は電極間の絶縁破壊の原因となり、案子の故障を引き起こす。

12

【0009】本発明はとくに、エレクトロルミネセンス 緊子の絶縁/誘電層と蛍光層を通過する放電を阻止する ものである。エレクトロルミネセンス案子をうまく動作 させるためには電極(アドレス線)が蛍光層から絶縁さ れることが必要である。このことは絶縁/誘電層によっ て行われる。典型的には絶縁/誘電層は蛍光層の両側に 設けられ、アルミナ、イットリア、二酸化珪素、シリコ ン窒化物またはその他の誘電材料から形成される。案子 の動作中、絶縁層と蛍光層との間の界面からの電子は、 これが蛍光層を通過するように電界によって加速され、 蛍光層でドーパント原子と衝突し、衝突プロセスの結果 として光を放出する。従来のTFEL素子では、蛍光体 を通過する電界強度が十分に高いことを保証するため、 誘電層の厚さは通常は蛍光層よりも薄いかまたは同じく らいである。誘電層が過度に厚いと、アドレス線間に供 給された電圧の大部分が蛍光層ではなく誘電層を通過す

【0010】誘電層は蛍光層とコンパチブルであることが重要である。 "コンパチブル"により本明細書および請求の範囲では、第1に良好な注入界面が形成されることを意味する。すなわち、 "熱"電子のソースが蛍光界面にあり、電界の適用に基づき蛍光層での導通および光放出を開始させるためこれを蛍光導通帯へ促進およびトンネルすることができることを意味する。第2にコンパチブルの意味には、誘電材料が、これが隣接層(すなわち蛍光体および電極)と反応を起こさないように化学的に安定していなければならないことを意味する。

【0011】典型的なTFELでは十分な発光を得るために、供給される電圧は誘電帯の絶縁破壊が発生する電圧に非常に近い。従って誘電層と蛍光層の厚さと品質に関する製造管理は絶縁破壊を阻止するため厳しく行われなければならない。この要求は反対に高い歩どまりを得ることを困難にする。

【0012】典型的なTFEL構造は(見る方向で)前 側から後側に形成されている。薄膜は連続的に適切な基 板にデポジットされている。ガラス基板は透明性を得る ために使用される。透明な前側電極(ITOアドレス 線) はガラス基板にスパッタリングにより約0.2ミク ロンの厚さでデポジットされている。基板誘電体-蛍光 40 体-誘電体層は通常はスパッタリングまたは真空蒸着に よりデポジットされる。蛍光層の厚さは典型的には約 0.5ミクロンである。誘電層の厚さは典型的には約 0. 4ミクロンである。蛍光層は通常はデポジットの 後、約450°Cで効率を高めるため焼き鈍しされてい る。次に後側電極が付加され、典型的には0.1ミクロ ンの厚さのアルミニウムアドレス線の形態である。完成 されたTEFLラミネートは外部の湿気からそれを保護 するためカプセル化される。エポキシ薄板カバーガラス またはシリコンオイルカプセルが使用される。デポジッ 50 トに使用される初期基板は典型的にはガラスであるか

30

ら、TEFLラミネート構造で使用される材料および析 出技術は高温処理をすることができない。

【0013】TFEL案子を動作させるのに使用される 高い電界強度は誘電層に過酷な要求を課す。高い絶縁耐 力は絶縁破壊を回避するために要求される。高い誘電率 を有する誘電体ができるだけ低い駆動電圧で発光効率を 得るために有利である。しかし高誘電率の材料を使用す る試みによっては満足する結果が得られていない。

【0014】TFEL素子の駆動電圧を低くするため、 絶縁層が高誘電率材料、例えばSrTiO3, PbTi O3, BaTa2O3から形成される。これは米国特許明 細書4857802号に記載されている。しかしこれら の材料は低い誘電ブレークダウン強度を良好に示すもの ではない。米国特許第4857802号明細書には、誘 電層をペロプスカイト結晶構造体から増大した平面配向 (111) を得るため薄膜析出技術により形成すること が記載されている。同明細書には、高い絶縁耐力(約8 ×10<sup>5</sup>~約1.0×10<sup>6</sup>V/cm) がSrTiO3, PbTiO3, BaTa2O3を使用した約0.5ミクロ ンの厚さの誘電層により得られることが記載されてい る。これらはすべて高い誘電率とペロブスカイト結晶構 造を有する。この素子は複雑で、誘電層に対する薄膜析 出技術で制御するのは困難である。

【0015】薄板セラミック絶縁層および薄膜エレクト ロルミンエセンスを使用したTFEL案子の開発も行わ れてきた (Miyata, Tら著SID 91 Dig est, pp70-73およびpp286-289参 照)。この素子はBaTiO3セラミックシートから形 成される。シートはファインBaTiO3パウダーをデ ィスク(直径20mm)に鋳造し、従来のコールドプレ ス法を使用して形成される。ディスクは1300°Cで 空気中で焼成される。次に約0.2mmの厚さのシート に研磨される。発光層は化学的真空析出法またはRFマ グネトロンスパッタリングを使用してシートに薄膜でデ ポジットされる。次に適切な電極層が薄膜技術を使用し て構造体のどちらか一方の側にデポジットされる。この 案子は所望の特性を示すが、商用TFEL素子をソリッ ドセラミックシートから製造することは好ましいことで はない。大きなセラミックシートを0.2mmの一定の 厚さに研磨することは経済的には実現できない。

【0016】多屬絶縁/誘電屬を蛍光層の両側で使用す ることも公知である。例えば、米国特許第489731 9号明細書には、EL蛍光層を絶縁堆積体ペアの間にサ ンドウィッチしたTFELが公知である。この場合、絶 縁堆積体の1つまたは両方はシリコン酸化窒化物 (Si ON) の第1の層とバリウムタンタル酸塩 (BTO) の 第2の比較的厚い層を有する。第1のSiON層は高絶 縁性を示し、第2のBTO層は高誘電率を有する。全体 的にこの構造体は従来の電圧での蛍光層の高い輝度を特 徴とするものである。しかし絶縁層がRFスパッタリン 50 ーザは電磁スペクトルで紫外線領域の比較的に短い波長

14

グによりデポジットされており、これは前に説明した薄 膜技術には不利である。

【0017】製造するのに有利で、従来のTFEL案子 よりも輝度が高く動作電圧が低いTFEL案子に対する 要求がある。これには案子を駆動するのに必要な電界強 度よりも高い絶縁耐力を有する誘電層を得ることが必要 である。

【0018】透明導電材料、例えばインジウムすず酸化 物に電極パターンを製造することはしばしば大規模で高 価なマスキングと、写真平板および化学エッチングプロ セスを含む。レーザがこのような透明導電材料に線引く するために提案されている。一般的には炭酸ガス、アル ゴンおよびYAGレーザが使用されている。このような レーザは電磁スペクトル領域の可視および赤外線領域 (一般的に400nm以上) に光を形成する。しかしこ のような長波長の光を電極パターンをスクライブするた めに使用することは、とくに透明導電材料が別の透明層 にデポジットされている場合に問題である。従来のTF ELディスプレイでは、透明電極材料、典型的にはイン 20 ジウムすず酸化物 (ITO) が透明ディスプレイがラス に、ELラミネートの他の層がデポジットされる前にデ ポジットされる。絶縁材料または半導体材料では、その 材料内の電子バンドギャップのエネルギーに相応するよ りも長い波長の光は強く吸収されない。光学的に透明な 材料に対しては、バンドギャップに相応する波長は可視 光線に対する波長よりも短い。従って透明電極材料はレ ーザ光をあまり吸収しない。これは光の波長が長いこと と層の厚さが薄いためで、このことはレーザエネルギー を電極アドレス線を直接除去するのに使用することを困 難にする。

【0019】米国特許第4292092号明細書および 米国特許第4667058号明細書には太陽電池におい て、透明電極パターンを別の透明層にデポジットするプ ロセスが記載されている。これらの特許明細番は電極を パルスYAGレーザを使用してパターニングすることを 開示する。しかしYAGレーザの波長は透明層で十分に 吸収されるには過度に長い。低い吸収率を補償するため に、ピークパワーの大きなレーザが透明電極を熱的に蒸 発させるために使用される。ネオジムYAGレーザは4 ~5W、36kHzのパルス率、20cm/sの走査率 40 で動作される。特許明細書に記載された実施例ではIT 〇層がこのようにしてガラスにデポジットされる。しか しスクライブされた線は I TOの不完全な除去を有する と記載されており、溶解した場所ではガラスが数百オン グストロームまでの深さを有する。残留ITOはその後 でのエッチングステップにより除去されなければならな

【0020】透明電極材料に電極パターンを形成する別 の手段はエキシマレーザを使用するものである。このレ

の光を生成する。この波長ではレーザエネルギーを透明 電極材料により吸収することができる。この性質のレー ザでは液晶ディスプレイ(米国特許第4980366号 明細費および米国特許第4927493号明細費)、光 ボルタ電池 (米国特許第4783421号明細書および 米国特許第4854974号明細書) および集積回路

(米国特許第5109149号明細書) に対して導電パ ターンを形成することが公知である。1990年8月2 3日に刊行されたWO90/0970には、電極ドット マトリクスパターンを透明基板上の透明導体にエキシマ 10 レーザによりスクライブするプロセスが記載されてい る。

【0021】エキシマレーザは透明電極により吸収する のに十分に短い波長の光を放射し、電極を直接除去する ことによりパターニングすることができる。しかしこの ようなレーザは比較的高価で、スクライブプロセスは下 にあるディスプレイガラスを溶解または除去しないよう に注意深く制御しなければならない。さらにこのような プロセスは透明電極材料を過度に除去したり不完全に除 去したりすることになりかねない。例えばWO90/0 970には、除去すべき材料を一部しか除去されなかっ た場合には、残った部分を化学的またはプラズマエッチ ングにより除去できることが記載されている。

【〇〇22】透明基板上の透明電極材料をスクライブす る場合の別の問題が米国特許第4937129号明細書 に記載されている。層間の拡散または相互汚染を回避す るため、拡散障壁層を界面に設けることが記載されてい る。

【0023】別の特許明細書には、レーザ光の吸収を増 強するため透明電極材料に表面処理することが記載され 30 ている。例えば米国特許第4909895号明細書に は、金属フィルム表面をレーザ光に対して比較的に反射 しないようにするため酸化することが記載されている。 米国特許第4568409号明細書には、除去が所望さ れる箇所でレーザ光が選択的に吸収されるように色素に より除去すべき透明層をコーティングすることが記載さ れている。

【0024】ELディスプレイを駆動する制御回路が開 発されている。基本的にはこの回路はシリアルビデオデ ータをパラレルデータに変換し、電圧をディスプレイの 40 行および列に供給する。上記のような行および列のドラ イバ索子(チップ)は入手可能である。

【0025】非対称駆動および対称駆動技術がELディ スプレイ技術で使用される。非対称駆動法では、ELパ ネルに駆動パルスが、負の閾値下電圧を1つの列に同時 に印加することにより供給される。各列のスキャン時間 中、正の電圧パルスが選択された行(すなわち発光すべ き行)に供給され、選択されなかった行(すなわち発光 すべきでない行)にはゼロ電圧が供給される。選択され 16

圧の和に等しい電圧がピクセルを介して供給され、発光 を惹起する。パネルのすべての列がアドレシングされた 後、正の極性リフレッシュパルスがすべての列に同時に 供給され、すべての行はOVに保持される。

【0026】対称駆動法では、リフレッシュパルスが省 略される。そのかわりに、反対の極性の駆動パルスセッ トがパネルに供給される。パネルを動作状態に保持する ため、列は交互の極性のパルスにより偶数フレームと奇 数フレームで走査される。交互の極性はすべてのディス プレイピクセルで正味のゼロ電荷を引き起こす。

【0027】上記のような高電圧ドライバ素子(チッ プ) は非対称および対称両方の駆動技術で入手可能であ

【0028】交互駆動回路およびELディスプレイに対 する案子は公知であり、開発されている。例えば、K. Shojiら著、Bidirectional Pus h-Pull Symmetric Driving Method of TFEL Disply, Spr inger Proceedings in Phys ics, Vol. 38, 1989, 324、およびSu ttonら著、Recent Development s and Trends in Thin-Film Electroluminescent Displ y Drivers, Springer Procee dings in Physics, Vol. 38, 1 989, 318、およびBolgerら著, A Sec ondGeneration Chip Set fo Driving EL Panels, SID, 1 985, 229参照。

【0029】上記の駆動法はマルチプレクス(パッシ ブ)マトリクスアドレシング法と呼ばれる。理論的には その他の駆動法、例えばアクティブマトリクスアドレシ ング法もELディスプレイに使用することができる。し かしこれらはまだ開発されていない。このような交互駆 動法は、本明細書で使用されるフレーズ電圧駆動回路の 意味の枠内であると見るべきである。

【0030】従来のELディスプレイでは、行および列 のアドレス線を駆動回路に接続する1つの手段は、非常 に密に近接した金属シートを非常に多数含む重合ストリ ップを、ディスプレイアドレス線に接続された接点列 と、駆動回路のドライバ素子に接続された接点列の間に 加圧することである。駆動回路は別個の回路基板に配置 されている (米国特許第4508990号明細書参 照)。重合ストリップは層構造のエラストメリックな素 子(LEE)であり、STAXおよびZEBRAの商品 名で知られている。LEEは導電エラストメリック材料 と非導電エラストメリック材料との交互の層からなる。 重合ストリップは数百の個別のワイヤをはんだまたは溶 接を使用して接点に接続するという骨の折れる接続作業 た行と列の交点では、閾値下の列電圧と行の正パルス電 50 を回避する。しかしこの相互接続技術は非現実的であ

り、重合材料をクリープさせるような高い温度では良好 に機能しない。

【0031】行および列アドレス線を液晶ディスプレイ(LCD)駆動回路に接続するため共通に使用される別の手段、すなわちチップオンガラス技術(COG)をエレクトロルミネセンスに対しても使用することが考えられる。アドレス線が接続されなければならない駆動素子(チップ)はディスプレイの末端周辺に配置される。LCDの場合、ディスプレイガラスの裏面に蒸着されているアドレス線がディスプレイのアクティブ領域から延在している。従ってアドレス線はパターンに配置された接点パッドで終端し、従ってチップをこれにボンディングすることができる。ワイヤボンディングはチップをディスプレイガラスに取り付け、ファインゴールドワイヤをチップの出力パッドおよびアドレス線の相応する接点パッドに個別に接続することを必要とする。

【0032】COG技術の利点はディスプレイガラスと駆動回路との間の接点数を格段に低減できることである。というのははるかに多数の接点がドライバチップとアドレス線の間にあるからである。典型的には20から30の接続がドライバチップと駆動回路の他の部分との間にあるにすぎないが、アドレス線とに間には2000もの接続がある。

【0033】COC技術の大きな欠点は、ドライバチップをアドレス線の薄膜パッドにワイヤボンディングすることの困難性である。そのため製造歩どまりが悪い。他の欠点はドライバチップを取り付けるためにディスプレイの周辺にスペースが必要なことである。従ってディスプレイの寸法が増大し、大型ディスプレイを形成するため複数のディスプレイモジュールをアレイに組み合わせることができないことである。

【0034】直接回路接続に対するスルーホール技術は

半導体分野で広く知られている(例えば米国特許第3641390号明細書参照)。米国特許第4710395号明細書から、制御された真空を用いたスルーホール基板プリントに対する方法および装置が公知である。しかしスルーホールプリントは、発明者の知るかぎりでは、ELディスプレイにうまく適用することができない。【0035】米国特許第3504214号明細書には、EL素子のセグメント記憶形式が記載されている。ここではピクセルが光電層を形成するため光によりターンオンされ、次に蛍光層が導電性となる。スルーホール導体の複雑性が記載されている。この明細書は通常のスルーホール接続は高解像度TFELディスプレイでは動作しないことを示唆している。なぜなら、導電材料が蛍光体

[0036]

である。

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率がよく、製造が容易で簡単なエレクトロルミネセン 50

と反応し、そのためディスプレイの能力が低下するから

18

ス緊子を提供することである。

[0037]

【課題を解決するための手段】上記課題は本発明により、扁平な層が約1.0×10<sup>6</sup> V/m以上の絶縁耐力と、誘電材料の誘電率と蛍光体の誘電率の比が約50:1以上である誘電率を有するセラミック材料から形成され、誘電層は誘電層と蛍光層との厚さの比が約20:1から500:1の範囲にある厚さを有し、誘電層は蛍光層に隣接する表面を有し、該表面は蛍光層とコンパチブルでありかつ十分に滑らかで、蛍光層は所定の励起電圧の下で一般的に均一に発光するように構成した誘電層を有するELラミネート誘電層構造体により解決される。【0038】発明の要約

エレクトロルミネセンスの層は異なる誘電率を有する。 ラミネートの層間の電位差は各層の厚さに比例して、また材料の相対的誘電率に反比例して各層に分散される。 例えば、1つの層が別の層の2倍の厚さと誘電率を有していれば、電圧はこれら2つの層に均等に分散される。 本発明はこの性質を利用して、高誘電率を有する厚い誘電層を、格段に低い誘電率を有する準光層と組み合わせるのである。このようにして蛍光層による導電が開始する前に、誘電層が十分に高い誘電率を有していればピクセルを通る電圧が蛍光層全体にわたって十分に存在することができる。本発明は新しい改善された誘電層を有するELラミネートと、その製造方法を提供する。 誘電層は圧膜として次のセラミック材料から形成される。 【0039】一絶縁耐力は約1.0×10<sup>6</sup> V/m以上である。

【0040】一誘電材料の誘電率(k2)と蛍光層の誘 電率(k1)との比は約50:1以上である(有利には 100:1以上)。

【0041】一誘電層の厚さ(d2)と蛍光層の厚さ (d1)との比は約20:1から500:1の範囲にあ る(有利には40:1から300:1)。

【0042】 - 蛍光層に隣接した表面は蛍光層とコンパチブルであり、十分に滑らかであり、蛍光層は一般的に所定の励起電圧で均一に発光する。

【0043】本発明の誘電層を含むラミネートは最も有利には蛍光層が薄膜層であるラミネートである。典型的な薄膜蛍光層はZnS:Mnから約0.2から2.0ミクロン、典型的には約0.5ミクロンの厚さで形成される。ZnS:Mn材料は約5から10の誘電率を有する。。理論的計算ではこの最も有利な蛍光層(前記のガイドラインを参照)に基づき、本発明の誘電層は有利には500以上の誘電率、最も有利には約1000以上の誘電率を有する。また厚さは約10から300ミクロンの範囲、有利には20から150ミクロンの範囲にある。高誘電率を得るためには強誘電材料が有利である。最も有利にはこれらはペロブスカイト結晶構造を有する。例えば材料は、PbNbO3, BaTiO3, SrT

20

iO3, PbTiO3を含む。

【0044】本発明の誘電層はラミネートに形成され、これは前側から後側に構成される。従って後側電極は基板にデポジットされ、最も有利にはアルミナのようなセラミックである。これは製造時にガラス基板よりもはるかに高い温度に耐えることができる(ガラス基板は前面の透明性を得るためTFEL構造体の前側から後側に使用される)。次の本発明の誘電層は圧膜技術によって後側電極にデポジットされる。これは高温で焼成されるが、これは基板と後側電極には耐えることができる。厚度技術と高温焼成の使用は誘電層の全体特性に対して重要である。というのは高度の結晶度を有する密な層が得られ、これは全体誘電率と層の絶縁耐力を改善するからである。

【0045】実際には発明者は、現在使用可能なセラミック材料を用いて蛍光層に隣接する誘電体の所望の表面(すなわちコンパチブルおよび滑らか)を製造することは困難であると思う。従って本発明の有利な実施例では、誘電層は2つの層として形成され、第1の誘電層は後側電極上に形成されて有利には高い絶縁耐力を有し、上記の誘電率値に設定される。第2の誘電層は上記のように蛍光層に隣接する表面となる。

【0046】本発明の有利な実施例では、第1の誘電層は圧膜技術(有利にはスクリーンプリント)によりデポジットされ、その後高温焼成(有利にはすべての下部層の溶融点よりも低い温度、有利には1000° C以下で)される。強誘電セラミック、有利にはペロブスカイト結晶構造体を含むペーストが、ペースト組成が高い焼成温度での焼成を許容するならば有利な材料である。第2の誘電層は有利にはゾルゲル技術によってデポジットされ、その後、滑らかな表面を得るため高温焼成される。第2の層に使用される材料は有利には高誘電率(有利には20以上、さらに有利には100以上)を有し、厚さは2ミクロン以上(有利には2から10ミクロン)である。ペロブスカイト結晶構造を有する強誘電セラミックが最も有利である。

【0047】本発明は、ニオブ酸鉛から30ミクロンの厚さでスクリーンプリントされた第1の誘電層と、ゾルとしてジルコン酸チタン酸鉛から2から3ミクロンの厚さでスピンデポジットされた第2の誘電層によって示された。ゾルゲル層はまた全体の厚さが6から10ミクロンの複数の層を形成するための浸漬によって示された。ランタン酸ジルコン酸チタン酸鉛もまたゾルゲル層として示された。

【0048】2層の誘電体を使用することは必須ではないが有利である。第1の誘電層が所要の高い絶縁耐力と高い誘電率を有する圧膜として形成されるのに対し、第2の層にはそのような制限はない。第2の層が所望のコンパチブルで滑らかな表面を有していれば、これは薄膜として第1の層で使用されるよりも多くの種々の材料か50

20

5形成することができる。多くの研究が、ELラミネートの誘電ー蛍光界面の特性を変化させること、例えば化学的安定性または注入の改善について成された。これらの改善を含む材料または析出技術は、本発明の第1および/または第2の誘電層とともに使用することができる。例えば第1または第2の層で使用される材料または析出技術の選択において第2の層の表面の変更により、または第1または第2の層の上部にさらに第3の薄膜層を適用することにより使用することができる。

【0049】本発明により製造されたラミネートは、低い動作電圧において絶縁破壊なしで良好な発光効率を示す。誘電層に対して有利な圧膜とソルゲル析出技術は一般的に簡単で前に説明した薄膜技術と比較して高価な技術でない。本発明の誘電層の別の利点は、層を組み込んだラミネートが蛍光層と第2の電極との間に別の誘電層を必要としないことである。しかし必要ならばこのような別の誘電層を含むこともできる。

【0050】従って本発明は、前側電極と後側電極との間にサンドウィッチされた蛍光層を含む形式のエレクトロルミネセンスラミネートにおける誘電層を適用するものである。後側電極は基板上に形成されており、蛍光層は後側電極から誘電層により分離されている。誘電層はセラミック材料から形成された扁平な層を有する。このセラミック材料の絶縁耐力は約1.0×10 $^6$ V/m以上であり、k2/k1の比である誘電率は50:1以上であり、誘電層はd2:d1の比が20:1から500:1の範囲であるような厚さを有する。さらに誘電層は、蛍光層とコンパチブルであり、十分に滑らかである蛍光層に隣接する表面を有し、蛍光層は所定の励起電圧で一般的に均一に発光する。

【0051】本発明はまた、前側電極と後側電極との間にサンドウィッチされた蛍光層を含む形式のエレクトロルミネセンスラミネートの製造方法に関するものである。この後側電極は基板上に形成され、蛍光層は後側電極から誘電層により分離されている。本発明の方法は、後側電極に圧膜技術でデポジットし、その後セラミック材料を焼成する。このセラミック材料はk2/k1の比が約50:1以上である誘電率を有し、約1.0×10<sup>6</sup> V/m以上の絶縁耐力と、d2/d1の比が約20:1か6500:1の範囲にある厚さを有する誘電層を形成する。誘電層は蛍光層に隣接する表面を形成する。この表面は蛍光層とコンパチブルであり、かつ十分に滑らかであり、所定の励起電圧の下で蛍光層は一般的に均一に発光する。

【0052】本発明はまた、少なくとも1つの上側層と少なくとも1つの下側層を有する扁平なラミネートにレーザでパターンをスクライブするプロセスに関する。このプロセスは、フォーカシングされたレーザビームをラミネートの上側層側に照射し、このレーザビームは実質的に上側層によっては吸収されないが下側層によっては

吸収されるような波長を有し、これにより下側層の少な くとも一部は直接除去され、上側層はその厚さ全体にわ たって間接的に除去される工程を含む。

【0053】ELラミネートに関連して、上側層は透明 導電材料かつ発光体であり、下側層は誘電層の1つまた は複数であり、パターンは平行に配置されたアドレス線 の電極パターンである。

【0054】明細書および特許請求の範囲全体を通して 以下の定義があてはまる。

【0055】吸収は、放射エネルギー量が材料内での高 10 エネルギー状態への許容遷移と一致したときに、例えば 材料に対してバンドギャップを通る電子の促進により材 料内で生じる。

【0056】レーザビームによる材料の直接除去は、除 去の主たる原因が分解である場合、および/またはレー ザビームの放射エネルギーの材料による吸収によるもの である場合に生じる。

【0057】レーザビームによる材料の間接的除去は、 除去の主たる原因が材料中での熱発生による蒸発である 場合、およびレーザビームの放射エネルギーを吸収する 20 隣接材料から搬送される場合に生じる。

【0058】本発明は、扁平なエレクトロルミネセンス ラミネートから駆動回路の1つまたは複数の電圧駆動素 子の出力側へスルーホールコネクタを使用して電気接続 を行うエレクトロルミネセンスディスプレイパネルに関 する。ディスプレパネルは、

- 基板裏面に形成され、公知の形式の公差アドレス線の フロントセットおよびリアセットを有するエレクトロル ミンエセンスラミネートと、

ーアドレス線の端部に隣接する基板に形成された複数の 30 スルーホールと、

- 基板のスルーホールのそれぞれを通ってアドレス線の 各端部へ、各アドレス線と駆動回路の電圧駆動素子との 電気接続を行うための導電経路形成手段とを有する。

【0059】有利には、ディスプレイパネルのエレクト ロルミネセンスラミネートは本発明の圧膜誘電層を有す る。この誘電層によりラミネートを後側基板から前側へ (見る方向で) 形成することができ、これによりまた、 電圧駆動素子とアドレス線との接続のためのスルーホー ルコネクタおよび圧膜回路パターンを、回路製造ステッ 40 プとエレクトロルミネセンスに対する製造ステップとの 交互組み合わせで形成することができるようになる。

【0060】このようなステップは簡単には従来のエレ クトロルミネセンスラミネート構造では実現することは できない。というのは、層がフロントディスプレイガラ スにデポジットされ、このガラスは圧膜導電ペーストを 焼成する温度には耐えられないからである。

【0061】本発明によれば、電圧駆動素子または駆動 回路全体は、後側基板の裏面に形成される。スルーホー 路との間のより直接的で信頼性の高い相互接続が得られ る。ディスプレイパネル周辺の非活性外辺部は必要ない (従来の技術では必要であった)。このことにより個々 のディスプレイパネルから大型ディスプレイを組み合わ

せることができる、しかもモジュール間に暗い境界線が 生じない。

#### [0062]

【実施例の説明】図1および図2には、2つの誘電層を 合わせた本発明によるELラミネート10が示されてい る。ラミネート10は基板12上に背面側から形成され る。背面電極層14は基板12上に形成される。図面に 示されているように、ディスプレイに適用するために、 背面電極14は、基板12上にセンタリングされた導電 性のアドレス線路の列から成り、基板エッジから間隔を おいて配置されている。電極14からは電気接点タブ1 6が突出している。背面電極14の上には第1の厚い誘 電層18が形成され、この次にはこれよりも薄い第2の 誘電層20が続いている。さらに第2の誘電層20の上 には燐光層 2 2 が形成され、この次には透過性の前面電 極層24が続いている。前面電極層24は図面ではソリ ッドに描かれているが、実際にディスプレイに適用する ためには、この電極層は、背面電極14のアドレス線路 と垂直に配置されたアドレス線路の行により構成され る。ラミネート10は、水分が侵入するのを避けるため に透過性のシール層26によりカプセル保護されてい る。第2の電極24には電気接点28が設けられてい

【0063】Eレラミネート10は、交流電力源を電極 の接点16、28と接続することにより作動される。本 発明によるELラミネートは、ディスプレイにおける用 途が最も多いものではあるが、ランプまたはディスプレ イとしての用途を有するものである。

【0064】当業者であれば、本発明の枠からはずれる ことなくラミネート10にさらに別の中間層を設けられ ることが理解されよう。

【0065】次に有利な材料および工程ステップととも に、1つのELラミネートに誘電層を2重に形成する本 発明による方法を説明する。

【0066】ラミネート10は、背面から前面(表示 面)へと形成される。ラミネート10は適切な基板12 上に形成される。基板12は有利にはセラミックであ り、これは誘電層で使われる高い焼結温度(典型的には 1000°C)に耐え得るものである。最も有利なのは アルミナである。

【0067】基板12上に第1の背面電極14がディポ ジットされる。アドレス線路の薄い列を配線するため に、多数の技術や材料が知られている。有利には、導電 性の金属のアドレス線路は、ペーストが印刷されるべき 領域で洗い落とすことのできる感光乳剤を用いて、Ag ルコネクタを使用することにより、アドレス線と駆動回 50 /Pt合金ペーストによりスクリーン印刷される。その

後、このペーストは乾燥され焼成される。択一的に、背 面電極14を金のような別の貴金属、あるいはクロム、 タングステン、モリブデン、タンタルまたはこれらの金 属の合金のようなその他の金属により形成することもで きる。

【0068】第1の誘電層18は、周知の厚膜技術によ り背面電極上にディポジットされる。燐火層22の誘電 率よりも高い誘電率を生じさせるために、第1の誘電層 18は有利には強誘電性材料から生成され、最も有利に はペロプスカイト結晶構造を有するものから生成され る。この材料は、ラミネートのための適切な動作温度に わたって、一般的には20°C~100°Cにわたっ て、500の最小誘電率を有するものである。いっそう 有利には、第1の誘電層材料の誘電率は1000または それ以上である。第1の誘電層18のための実例として の材料は、PbnbO3、Batio3、SrTiO3 およびPbTiO3 であって、殊にPbNBO3 が好ま しい。

【0069】第1の誘電層18のためにセラミック材料 (すなわちラミネートの別の層を準備するのに十分に高 20 い融点を有する電気的に絶縁する部材)を選択する場 合、当業者であれば理解されるように、高い誘電率と高 い絶縁耐力を有するものとして知られた材料が選択され る。これらは材料の固有の特性であるが、緻密で透明な 形状で存在するバルク材料に対して値が一般的に定めら れている。用いられるディポジット技術によりこれらの 特性を変えることができる。材料の誘電率に関して、誘 電率を出発材料の誘電率よりも著しく下げないようにす る目的で、厚膜ディポジション技術およびこれに続く高 温焼結により(約1ミクロンから約2ミクロンの範囲内 30 下で述べるように相互に関係がある。燐光層に対し約 の) 大きな粒子サイズと、緻密な構造における高い透明 度が全体的に維持される。同様に、厚膜ディポジション 技術を用いることにより高い絶縁耐力が得られる。しか し層の絶縁耐力は結局は、完成したラミネートに動作電 圧を印加することにより測定すべきである。

【0070】厚膜ディポジション技術は、上述のように 従来より公知である。このような技術の場合、誘電材料 は、全体的に均一な範囲の所望の厚さで、背面電極14 上にディポジットされる。厚膜ディポジション技術は、 セラミック基板上の電子回路の製造時に頻繁に用いられ 40 る。スクリーン印刷は最も好ましい技術である。ペース ト製造者により行われる推奨される焼結ステップで、市 販の誘電ペーストを用いることができる。ペーストは、 典型的には約1000°Cである高温の焼結を可能にす るように選択または形成すべきである。しかし他の技術 で同様の結果を得ることができる。択一的である厚膜技 術は、背面電極14上に配線できるように"グリーンテ ープ"として誘電体を用いることである。このグリーン テープは重合マトリクスの誘電性粉体を有しており、こ れは後続の焼結プロセス中に燃焼させることができる。

24

焼結前、このテープはフレキシブルであり、電極層14 上に平らに広げて押圧させることができる。スクリーン 印刷された誘電体上におけるグリーンテープの1つの可 能な利点は、これが燃焼されれば孔がいっそう僅かにな ることでいくらか緻密できることである。現在、グリー ンテープ誘電体は容易に入手可能ではない。誘電体の厚 膜ペーストも、背面電極層14上に平らに広げて被着さ せることができるし、あるいはドクタブレードで塗布す ることができる。誘電性粉体の静電的なディポジション およびこれに続く、粉体がその静電荷を失なう前にただ ちに行われる焼結のようないっそう複雑な技術を、付随 的に用いることもできる。

【0071】図示されているように、第1の誘電層18 は有利にはペーストによりスクリーン印刷される。僅か な有孔性、高い結晶度および最小の解砕を達成するため に、多重層へのディポジットおよびこれに続く高温での 焼結が有利である。焼結温度は、使用される個々の材料 に依存するが、背面電極14または基板12が耐え得る 温度を越えないようにする。大部分の電極材料にとっ て、典型的には1000°Cの温度が最大値である。第 1の誘電層18の厚さは、この層の誘電率と、燐光層2 2および第2の誘電層20の誘電率および厚さにより変 化する。一般的に、第1の誘電層18の厚さは10~3 00ミクロンの範囲内であり、有利には20~150ミ クロンの範囲内であり、さらに有利には30~100ミ クロンの範囲内である。

【0072】一般的に、誘電層の厚さおよび誘電率を定 めるための基準は、最小動作電圧で適切な絶縁耐力が生 じるように計算されるものとされる。これらの基準は以 0. 2~2. 0ミクロンの間の典型的な厚さの範囲(d 1)を与え、この燐光層に対し約5~10の間の誘電率 の範囲 (k1) を与え、さらに誘電層に対し約106~ 10<sup>7</sup> V/mの絶縁耐力の範囲を定めると、本発明の誘 電層のための典型的な厚さ(d2)と誘電率(K2)の 値を決定するために以下の式および計算を適用できる。 上記の典型的な範囲を意味をもって変えようとする場合 には、本発明の枠内からはずれることなく、これらの式 ならびに計算をd2 とk2 の値を決定するためのガイド ラインとして用いることができる。

【0073】1つの均一の誘電層と、2つの導電性の電 極間に挟まれた1つの均一の非導電性の燐光層とを有す る2重の層に加わる電圧Vは、式1により定められる:  $V = E_2 * d_2 + E_1 * d_1$ この場合、E2 は誘電層における電界強度、E1 は燐光 層における電界強度、d2 は誘電層の厚さ, d1 は燐光 層の厚さである。

【0074】これらの計算において、電界方向は、燐光 層と誘電層との間の介在領域に対し垂直である。式1 50 は、閾値電圧よりも低い電圧が印加されるかぎりあては まる。この閾値電圧において、燐光層における電界強度 は、燐光層が電気的に降伏し始め、素子が光を送出し始 めるのに十分に高いものである。

【0075】電磁理論により、異なる誘電率を有する2つの絶縁材料間の介在領域に垂直な電気変位(電東密度)Dの成分は、介在領域にわたり連続的である。ある材料中のこの電気変位成分は、誘電率と、同じ方向の電界成分との積として定義されている。この関係から、2重層構造における介在領域に対し式2が導出される:

$$k_2 * E_2 = k_1 * E_1$$
 (2)

この場合、k2 は誘電材料の誘電率であり、k1 は燐光材料の誘電率である。

【0076】式1および2を合成して式3を得ることができる:

$$V=(k_1*d_2/k_2+d_1)*E_1$$
 (3) 閥値電圧を最小化するために、式 $3$ の第 $1$ 項は実用に即して小さくする必要がある。燐光層の発する光を最大にするために、第 $2$ 項は燐光層の厚さの選択の要求により定められる。これらの数値を定める際、第 $1$ 項は第 $2$ 項の $1$ 0分の $1$ の大きさになるように選択する。この条件

$$d2 / k2 = 0. 1 * d1 / k1$$
 (4)

を式3に代入することにより式4が得られる:

式4により、燐光層の特性に関して誘電層の厚さとその 誘電率との比が得られる。この厚さは、燐光層が関値電 圧を超過して導通したときに、印加された電圧全体を保 持するのに絶縁層の絶縁耐力が十分であるようにすると いう要求から独自に決定される。厚さは式5を用いて算 出される:

$$d_2 = V/S (5)$$

この場合、Sは誘電材料の絶縁耐力である。

【0077】上述の式およびd1、k1、Sに対し適切な値を用いることにより、本発明明細書および特許請求の範囲に記載した誘電層の厚さならびに誘電率の範囲が得られる

【0078】前述のように、第1の骸電層18が、燐光層と隣接する十分に滑らかな表面を有し(すなわち続いてディポジットされる燐光層が所定の励起電圧で全体的に均一に発光するのに十分な滑らかな表面を有し)、この燐光層22と両立性があれば、第2の骸電層20は不要である。一般的に、表面の起伏が約1000ミクロン(これは1つのピクセル幅にほぼ等しい)にわたって約0.5ミクロンより大きく変化していなければ十分である。この間隔において0.1~0.2ミクロンの表面起伏であればいっそう好ましい。第1の骸電層18が十分に滑らかな表面を有していても燐光層22との所望の両立性を有していなければ、両立性を得るためにさらに別の材料層(有利には骸電層であるがそうである必要はない)を、たとえば薄膜技術により加えてもよい。

【0079】第2の誘電層20が必要とされる場合、この層は第1の誘電層上に生成される。第2の誘電層20

26

は第1の誘電層18の誘電率よりも小さい誘電率を有す ることができ、典型的にはさらに薄い層(有利には25 クロンよりは大きくいっそう有利には2~10ミクロ ン)として生成される。第2の誘電層の所望の厚さは一 般的に滑らかさの関数であり、つまり滑らかな表面が得 られるならば、この層はできるかぎり薄くすることがで きる。滑らかな表面を得るために、有利にはゾル・ゲル ・ディポジション技術が用いられ、これに続いて高温で の焼結が行われる。ゾル・ゲル・ディポジション技術は 従来からよく知られており、たとえば"Fundamental Pri 10 nciples of Sol Gel Technology", R. W. JonesThe I nstitute of Metals, 1989 を参照されたい。一般的 に、ゾル・ゲル・プロセスにより、溶剤をまだ保持して いる間、コロイドゲルまたは重合高分子網状構造として 溶液から取り出される前に、ゾルにおいて分子レベルで 材料を混合することができる。溶剤を除去すれば、高レ ベルの緻密な多孔率の固体が残される。したがって表面 自由エネルギーの値が高められ、その他のほとんどの技 術を用いて行われるよりも低い温度で固体を焼結し濃度 を髙めることができる。

【0080】ゾル・ゲル材料は、滑らかな表面を得るよ うに第1の誘電層18上へディポジットされる。このゾ ル・ゲル・プロセスにより、滑らかな表面を生じさせる ことに加えて焼結された厚膜層上の孔を埋めることがで きるようになる。スピンディポジションまたは浸せきが 最も好ましい。これらは長年にわたり半導体産業におい て主として写真製版プロセスで用いられている技術であ る。スピンディポジションの場合、高速で一典型的には 毎分数千回転でースピンする第1の誘電層18上へゾル 30 材料がドロップされる。望ましければゾルを数段階、デ ィポジット可能である。層20の厚さは、ゾル・ゲルの 粘度を変化させることにより、およびスピン速度を変え ることにより制御される。スピニングの後、湿ったゾル ・ゲルの薄い層が表面上に生成される。セラミック表面 を生成するために、一般的には1000°Cよりも低い 温度でゾル・ゲル層20が焼結される。ゾルは浸せきに よってもディポジットできる。被覆されるべき表面がゾ ル中へ浸され、次に一定の速度で一通常は著しくゆっく りと一引き出される。層の厚さは、ゾルの粘度および引 き出し速度を変化させることにより制御される。さら に、ゾルをスクリーン印刷またはスプレイコーティング してもよいが、これらの技術では層の厚さを制御するの は比較的困難である。

【0081】第2の誘電層20に使用される材料は有利には強誘電性のセラミック材料であり、高い誘電率を生じさせるためにこのセラミック材料は有利にはペロブスカイト結晶構造を有する。有利にはこの誘電率は、2つの誘電層18、20における電圧変動を避けるために、第1の誘電層の誘電率と同様のものである。とはいえ、50 第2の誘電体20で用いられるいっそう薄い層では誘電

27

率は約20だけ小さい誘電率を使うことができ、しかし有利には100より大きくする。実例としての材料には、ジルコン酸ーチタン酸鉛(PLT)、ランタン酸ージルコン酸ーチタン酸鉛(PLZT)、および第1の誘電層18で使用されるSr、PbおよびBaのチタン酸が含まれ、この場合、PZTとPLZTが最も好ましい。

【0082】次の層のディポジションに好適な滑らかなセラミック表面を生成するために、PZTまたはPL2Tは有利には、スピンディポジションおよびこれに続く約600°Cより低い温度での焼結により、ゾル・ゲルとしてディポジットされる。

【0083】ディポジットされるべき次の層は典型的には燐光層22であるが、上述のように、燐光層との介在領域をいっそう改善する目的で、本発明の枠内で第2の誘電層20の上にさらに別の層を設けることもできる。たとえば、良好な注入性と両立性が得られることで知られた材料の薄膜層を用いることができる。

【0084】燐光層22は、電子ビームエバポレータに\*

基板層 アルミナ

背面電極 Ag/Ptアドレス線路

第1の誘電層 ニオブ酸鉛

第2の誘電層 ジルコン酸ーチタン酸鉛

 燐光層
 ZnS:Mn

 前面電極
 ITO

 シール層
 ガラス

大きなELディスプレイの場合、層の厚さを変化させることができる。たとえばゾル・ゲル層の厚さは、所望の滑らかさを得るために典型的には約6~10ミクロン増やされる。同様に、ITO層の厚さは大きなディスプレ 30イの場合には0.3ミクロンまで増やすことができる。【0089】本発明によれば、エレクトロルミネセンスラミネートの前面と背面のアドレス線路と電圧駆動回路との接続は、有利には背面基板中のスルーホールを貫通させることにより行われる。ELラミネートは本発明の厚い誘電層を一これは必要ではないが一有するのが最も

好ましい。

【0090】電圧駆動回路は(典型的には高電圧駆動チップと称される)電圧駆動コンポーネントを有している。ビデオ入力信号に応じてピクセルを選択的に励起させるために、このコンポーネントの出力側は、背面電極と前面電極の個々の行アドレス線路と列アドレス線路に接続されている。電圧駆動回路およびコンポーネントは従来技術において一般的に知られている。本発明を説明するために、スルーホール接続は、公知のパッケージ化された高電圧駆動チップ用に設けられたものであり、この高電圧駆動チップは、周知のリフローはんだ付け技術により背面基板上に表面取り付けされる。この形式の高電圧駆動チップは、慣用の対称パルス駆動形および非対称パルス駆動形として知られている。

\*よる真空蒸着やスパッタリング等のような周知の薄膜ディポジション技術によりディポジットされる。好ましい 燐光材料は2nS:Mnであるが、異なる色の光を発す る別の燐光体も知られている。燐光層22は典型的には 約0.5ミクロンの厚さと約5~10の誘電率を有す

【0085】 燐光層22の上の別の透過性の誘電層は不要であるが、望ましければ設けてもよい。

【0086】前面電極層24は燐光層22(設けられて いるならば別の誘電層)上に直接、ディポジットされる。この前面電極は透過性であり有利には、電子ビームエバポレータにおける真空蒸着のような薄膜ディポジション技術で知られているインジウムスズ酸化物(ITO)から生成される。

【0087】ラミネート10は典型的には焼きなまされ、次にガラスのようなシール層26で密閉される。

【0088】本発明による典型的な厚さの値を有する有利なラミネートは、背面から前面までについて以下のとおりである:

10ミクロン

30ミクロン 2ミクロン

0. 5ミクロン

0. 1ミクロン

10~20ミクロン

【0091】しかし、当業者ならば気付くように、特殊 なドライバ回路ないしドライバ構成要素は変形可能であ り、そのようにして、当然、貫通ホールのパターンおよ び、ドライバ回路に接続するために設けられた回路パタ ーンに影響を与えることがある。本発明は、実施例とし て、ドライバ回路全体またはその一部分だけを後側の基 板上に取付けることができる。例えば、高圧パッケージ チップを使う代わりに、むき出しのシリコンダイ(チッ プ)を慣用のダイアタッチ方法を用いて基板上に使うこ とができ、そして、慣用のワイヤボンディング技術を用 いてチップを基板上のドライバ回路に接続することがで きる。この場合、ドライバチップは、基板上の僅少な領 域しか占有せず、ドライバ回路のすべてを基板上に配設 することができる。その結果、超薄形ディスプレイパネ ルを、直接ビデオ信号にインターフェース結合し、かつ 直接直流電力源に接続することができる。そのようなデ ィスプレイは、ディスプレイを必要とする超薄形ポータ ブル製品で有用である。もちろん、基板の後側にドライ バ回路を取付けることができることは、いかなるサイズ のディスプレイにも適用でき、比較的大きなディスプレ イならば、基板の後側に直接ドライブ回路を設けるため に一層大きなスペースを提供することができる。

【0092】本発明の回路接続状態が、図3~図10に 50 示されている。上述のように、特殊な質通ホールと回路

20

パターンは、図示の目的のために、後側基板の反対側に 高圧ドライバチップ30を取付けるために設けられてい る。特殊なチップ選択は、スーパーテックスHV702 2 P J が列アドレス線 1 4 への接続用であり、スーパー テックスHV8308PJおよびHV8408PJ (ス ーパーテックス社、カリフォルニア州、サニーベイル 在)が行アドレス線24への接続用である。後者の2つ のチップは、一方のリードパターンが他方のリードパタ ーンのミラーイメージであるという点で異なっている。 【0093】図を参照すると、ELラミネート10は、 有利には(必ずというわけではないが)、本発明の2層 誘電層18,20で構成されており、このようにして後 側の基板12から前方から視た側に向かって構成されて いる。後側基板12は貫通(スルー)ホール32と共に 穿孔されており、そのパターンは、基板12と貫通ホー ル32とがアドレス線14,24 (後で形成される)の 両終端に最も近くなるようにされている。または、択一 的に、付加的な貫通ホールをアドレス線に沿って所定の 間隔を置いた関係で設けることができる。これは、高抵 抗性の前方ITOアドレス線への接続を行なうのに有用 である。図4のパターンは、方形基板12上のELラミ ネート10への接続用であり、方形基板12には、列ア ドレス線(後側電極)14が比較的長い寸法に沿って設 けられ、行アドレス線(前側電極)24が比較的短い寸 法に沿って設けられている。

【0094】貫通ホール32は、有利にはレーザによっ て形成される。ホール32は、典型的には、レーザ穿孔 プロセスの性質により一方の側面上に拡げられており、 その側面は、導電材料をホールの中に通すのを容易にす るために後側面か反対側面であるように選択される。

【0095】ELラミネートで使われる基板12は、後 続の処理ステップで遭遇する温度を引下げることができ るようなものであるべきである。典型的には、使われる 基板は、ラミネートを堅固に支持するのに充分なもので あって、後続の、薄膜ペーストおよびゾル・ゲル材料用 の焼成焼結に耐えるために850°以上の温度に対して 安定しているものである。従って、基板は、レーザ光に 対して不透過性であるべきであり、それは、レーザ穿孔 により貫孔ホール32を形成できるようにするためであ る。最後に、基板は、後続ステップで使われる薄膜ペー ストの良好な付着性を提供すべきである。クリスタルラ インセラミック材料と不伝導性ガラス状材料が使われ る。アルミナは特に有利である。

【0096】導電材料の回路パターン34は、図5に示 されたパターンで、基板12の後側面に印刷される。こ のステップでは、導電材料は、上述のようにして、貫通 ホール32を通って引かれる。基板12の後側面の回路 パターン34は、貫通ホール32の毎々の周囲の後側コ ネクタパッド36、高圧ドライバチップ(図示していな

イブ回路(図示していない)の残部に接続するためのコ ネクタパッド (ラベルされていない)、および図示のよ うに多数のコネクタパッド間の電気リード(ラベルされ

30

【0097】導電材料は、有利には、スクリーン印刷に よって付けられた導電薄膜ペーストである。

ていない)から構成されている。

【0098】各貫通ホール32を貫通する導電路を形成 するために、基板12の前方側面上が真空にされ、他 方、回路34は、後側面に印刷される。これは、有利に は、基板12をマスタプレートを有する真空テーブル上 10 に置くことによって達成され、その際、マスタプレート は、基板12と真空との間で図4のパターンで穿孔され たホールを有している。マスタプレートの各ホールは、 整列され、基板12のホールより幾分大きい。 真空が均 一に加えられるのを確実にするために、回路が印刷され るまで、真空は加えられない。真空は、導電材料が基板 の前方側面へ貫通して引かれるまで続けられる。その時 点で、導電材料の小量が基板12の前方側面へ貫通して 引張られ、貫通ホール壁が被覆される。薄膜ペースト は、それから、公知の手順に従って焼成される。

【0099】このステップに続いて、回路パッド補強パ ターン42は、有利には(必ずではないが)、図7に示 されたように印刷される。導電材料と同様に、印刷およ び焼成ステップが続けられる。

【0100】列アドレス線14とコネクタパッド40 a, 40 bは、それから、基板12の前方側面に形成さ れ、有利には、銀/プラチナペーストのような薄膜導電 ペーストをスクリーン印刷することによって行なわれ る。アドレス線パターンは図6に示されており、基板1 2の長手方向に沿って延在し、前方(列)コネクタパッ ド40aで終わる列を有している。この同じステップの 間、前方(行)コネクタパッド40bは、行アドレス線 を貫通ホール32を経てドライブ回路に最終的に接続す るために設けられている。導電ペーストは、有利には、 上述のように、貫通ホール32を通って引き抜かれ、そ の際、基板の後側回路側から真空が加えられる。

手段は、薄膜導電ペーストから形成されるために、上で 詳述したが、導電ペーストは、従来技術で公知のよう に、電気プレートされた貫通ホールのように、または非 電気的プレーティングによって貫通ホールが形成される ようにして、形成され、そのようにして、基板に適切に 付着した電気プレートされた材料が提供され、および後 続層がプレートコンダクタに付着される。

【0101】貫通ホール32を通って導電路を形成する

【0102】本発明の薄膜誘電層18は、その際、有利 に形成され、上述のようにして焼成される。

【0103】基板の後側回路面は、その際、後側シーラ ント44を用いて有利にシールされ、その際例えば、薄 膜ガラスペーストを用いたスクリーン印刷によって、コ い)の出力用のチップコネクタパッド38、更に、ドラ 50 ネクタパッドを髙圧ドライバチップの取付のために、お よびコネクタピン45をドライバ回路(図示していない)の残部に取付けるために、露出したままにされている。シーリングパターンは、図8に示されている。

【0104】ELラミネートは次にゾルゲル層20、りん層22およびフロント行アドレス線24により補完される。フロント行アドレス線24のためのパターンは図9に示されている。これはフロント(行)コネクタパッド40の近傍で終端する基板12の厚さにわたる平行の行から構成する。必要に応じて、行アドレス線24とフロント(行)コネクタパッド40との間の電気的相互接 10 続46は、信頼できる電気的接続の目的で設けられる。これらは有利に、図10に示されているパターンでシャドウマスクを介して、銀のような導電材料をプリントすることにより形成される。

【0105】前述のフロントシーリング層26が湿気透過を阻止する目的で設けられる。

【0106】本発明によれば、ELラミネート10のフロントITOアドレス線24は、有利にレーザ書き込みにより形成される。このレーザ書き込み技術を、本発明の有利なELラミネート10に関連づけて示す。しかしレーザ書き込み技術は、上側層および下側層を有するプレーナラミネートをパターン化する時に一層広く適用されることは、理解されるべきである。この点に関して、ITOおよびりん層24,22は、実質的にレーザ光を吸収しない上側層を有する。さらに厚膜なまりニオビウム誘電体層18となまりジルコン酸塩チタン酸塩のゾルゲル層20は、レーザ光を吸収しない下側層を有する。他の代表的な材料は透明な(透光性の)導体としてSnO2、In2O3を含む。

【0107】通常は、本発明の思想において、上側層は 30 可視光線を透過する材料であり、下側層は可視光線を透過しない材料である。そのため下側の材料は直接的に穿孔され、上側層は間接的に穿孔される。この場合に可視の領域における、または電磁スペクトルの赤外線領域における波長を有するレーザービームを用いて、穿孔される。このレーザーによる穿孔法は、半導体、液晶ディスプレー、ソーラセルおよびELディスプレーにおいて広く使用される。

【0108】レーザー書き込みの精度および分解能(切り込みの深さおよび幅)を制御する目的で、かつ層の爆発的な非薄片化を回避する目的で、および層の間の相互拡散を最小化する目的で、材料の所定の特性および層の厚さを守るべきである。

【0109】2層のラミネートに関して次の関係が維持される。

[0110] ただし  $\alpha_u T_u > \alpha_o T_o$ 

αu=下側層の吸収係数、

αο=上側層の吸収係数、

Tu=下側層の厚さ、

To=上側層の厚さ、

32

頵αu Tuは頵αo Toよりも著しく大きくすると一層有利 である。

【0111】複数個の上側透明層および/または複数個の不透明層が設けられる時は、各々の層に対する積 $\alpha$ u Tuの和が、各々の層に対する積 $\alpha$ o Toの和よりも大きくすべきである、即ち

 $\Sigma i \alpha u i T u i > \Sigma i \alpha o i T o i$ 

上述の関数が維持される時は、本発明のステップにより 下側層の一部だけを、その全体の厚さを質通して切り込むことなしに、直接穿孔すべきであり、上側層の全体の 厚さを貫通して間接的に穿孔すべきである。

【0112】間接的な穿孔により上側層が軟化できる前におよび/または気化する前に、下側層の中において熱または蒸気圧が形成されると、爆発的な非ラミネート化が生ずることがある。それ故、上側層における材料は、下側層における材料が融解して気化する温度よりも、低い温度で融解して気化すべきである。

【0113】高い分解能の切り込む性能を向上させる目的で、下側層における材料の熱伝導率を、上側層における材料のそれよりも小さくすると有利である。両方の層の熱伝導率は、穿孔されつつある領域から、この領域がレーザ光に照射されている間中に、大きい熱が放熱されないように選定される。

【0114】 層の間の物質の相互拡散を回避する目的で、この過程のための拡散時間は、穿孔されるべき領域がレーザビームに照射されて時間よりも、長くすべきである。

【0115】前述の特性は材料に対して知られており、 どの材料が本発明のレーザ書き込み過程に適切であるか を前もって知らせることができる。

【0116】レーザ切り込みの分解能、爆発的な非ラミネート化および相互拡散も、レーザビームのエネルギおよび走査速度により影響される。しかし前述の関係が守られると、これらの別のレーザ条件が通常は維持されて、これらの別のレーザ条件は、直接的な穿孔および間接的な穿孔の所望の結果を達成するために制御および変化が可能となる。

【0117】可視領域または赤外線領域における液長を有するレーザビームを供給するレーザ光線は公知である。二酸化炭素レーザ、アルゴンレーザおよびYAGレーザはその一例である。全部のレーザは400nmより大きい液長を有する。パルス液レーザまたは持続液レーザを使用できる。後者は鋭い高い分解能の切りこみを形成するために有利である。レーザビームは適切なレンズ装置により集束される。その目的は上側層の完全な除去のための、十分な局所的な密度を保証するためである。通常はレーザビームのエネルギー密度は、カットされる構が、上側の透明層の厚さよりも十分に大きくなるように、設定される。透明層が電極アドレス線を含む時は、

50 これにより、アドレス線が明瞭に定められ電気的に絶縁

されることが保証される。

【0118】 書き込みは、書き込みされる材料に対してレーザビームを移動させることにより行なわれる。一層有利には、書き込みされるべき材料を、レーザビームに相対的に移動可能な x y 座標テーブル上に載置することにより行なわれる。

【0119】アドレス線を書きこむためには、x方向へ (即ち書き込みされるアドレス線に垂直に)移動可能な テーブルが有利であり、レーザビームはy方向へ即ちア ドレス線に沿って移動可能である。

【0120】レーザ書き込み中に気化されるまたは分解される材料は、レーザビームの近傍に設けられる真空により、書き込みされる材料から除去できる。

【0121】本発明による有利なELラミネート10、酸化インジウムすずの薄い層24は公知の方法によりりん層22の上に被着される。ITOを被着するための真空被着法またはITOを被着する方法は、米国特許第4568578号公報および第4849252号公報に示されている。ITO以外の材料を例えばふっ素でドーピングされた酸化すずを使用することもできる。光学的に205明な誘電体層は、ITOとりん層24,22との間に設けることができる。P2Tの有利なゾルゲル層20およびなまりニオビウムの厚膜誘電体層が、りん層の下に設けられる。ELラミネート10は、上述の様に、従来のTFEL装置とは逆のシーケンスで形成される。これは従来の様に、下側の不透明な誘電体の層18,20の上方の上側の透明層として、本発明によるレーザ書き込みに適するITO層24およびりん層22を残す。

【0122】個々の行アドレス線24は前述のようにレーザで書き込みされる。レーザビームはゾルゲル層20の少なくとも一部および、厚い下方の誘電体層18のわずかな部分を直接除去し、ITOおよびりん層24,22をそれらの厚さにわたり間接的に除去する。これは隣り合うアドレス線の間の信頼できる絶縁ギャップを残す。

【0123】行アドレス線24は上述の駆動回路へ接続されている。詳細には上述の有利な貫通ホール接続により、電気的な相互接続46が(レーザ書き込みに先立って)、図10で示されたパターンで銀を蒸着することにより、最終的にアドレス線を形成するITO層の一部と 40 重なる位置において形成される。

【0124】次にアドレス線が上述のように書き込みされる。

【0125】完成されたELラミネートは上述のように、フロント可視面上に保護用ポリマーシールをスプレーすることにより、またはフロント表面へガラス板を接着することにより、シールできる。

【0126】透明な導体材料を書き込みするための間接 的な穿孔を用いることにより、複数個の利点が得られ る。高い瞬時出力を有する紫外線パルスレーザではな 34

く、可視領域における光を送出する著しく低いエネルギ ーの接続波レーザが使用できる。このレーザはコストを: 低減できるだけでなく、削除された切り込み上の一層な めらかな線を形成する。このことは高い解像度のELデ ィスプレーのために著しく重要である。透明材料の直接 の穿孔は、穿孔の行なわれる領域から熱が拡がる阻止す るのに十分短い時間における穿孔のために必要なエネル ギーを送出する著しく高い瞬時レーザエネルギーを必要 とする。透明な基板上に設けられる透明な導体を直接穿 孔するための従来技術における試みにおいては、レーザ 10 エネルギーのごく小部分だけが、透明な導体材料により 直接供給される;光の大部分は両方の透明な層を通過す る。多くの場合、間接的な穿孔は、層の間の相互拡散の 問題点を最小化する。なぜならば透明層の気化させるた めの熱は透明層の底から生ずるからである。このことが 下側の層の中への材料の拡散ではなく、穿孔される材料 の外部への除去を促進する。このことはELディスプレ ーにおける誘電体層およびりん層の品質を維持するため に重要である。

【0127】本発明はさらに以下の変形実施例により示されている。

#### 【0128】 実施例1

この実施例は、バリウムチタン酸塩の厚膜層 (Miyata他の文献におけるセラミックシートとして用いられる材料)を簡単に印刷することが、条件の下での電気的 絶縁破壊に左右されることを示す。

【0129】単1ピクセルエレクトロルミネセンス素子 は、Coorsセラミック(Grand Juncti on, Colorado, U.S.A) から得られるア ルミナ基板 (5 c m 平方、厚さ 0.1 c m) の上に形成 された。背面電極層が基板上に中央に縁からは離されて 当接される。使用される材料は銀/プラチナ導体であ る。これは電子工学においては従来のようにアドレス線 として印刷されている。詳細にはCermalloy# C4747 (Cermalloy, Conshohoc ken, Paから入手可能である)が、320のメッシ ュステンレススチールスクリーンにより厚膜ペーストと してスクリーン印刷され、感光剤でコーティングされ た。この感光剤はフォトマスクを通して紫外線で照射さ れた。その目的はプリントのために維持された感光剤の 領域を露光するためである。露光されなかった感光剤は 水で溶かして除去された。この個所にはペーストがスク リーンを通して印刷される。次に残りの感光剤が付加的 な光照射によりさらに硬化された。プリントされたペー ストは150℃の炉の中で数分間、乾燥されて、このペ ーストメーカによりすすめられる温度プロフィールでB TUモデルTFF142-790A24ベルト炉におい て空気中で加熱された。最大プロセス温度は850℃で あった。加熱された電極導体層の得られた厚さは約9ミ 50 クロンであった。

この実施例は、なまりニオブ酸塩―この材料はバリウム チタン酸塩よりも高い誘電定数および低い焼結温度を有 することが知られている―を含むペーストから成るスク リーンプリント誘電体層が、適切な誘電率を与えるが発 光はしないことを示す。

36 .

【0130】誘電体層はこの電極層の上に次のようにして形成される。バリウムチタン酸塩(ESL#4520ーElEctroscience Laboratories, King of Prussia, Pennsylvaniaから入手可能、誘電定数2500-3000)が200メッシュスクリーンを介して平方形のパターンにプリントされる。その結果、電極の線における電気接触パッドを除いて、すべてがおおわれた。印刷された誘電体ペーストは、製造者によりすすめられる温度プロフィルによりBTU炉の中の空気中で加熱された

【0137】素子は実施例1におけると同様に構成される。しかしニオブ酸塩の誘電体ペースト、Cermalloy#IP9333(誘電体定数は約3500、厚さは実施例1と同じ)から構成される誘電体層を有する。この素子は、テストされた時に、DC電圧400Vが加えられた時にも誘電体絶縁破壊が生じなかった。しかしAC電圧を加えても発光しなかった。

(最大温度 900 - 1000 $^{\circ}$ )。得られた加熱された 誘電体の厚さは  $12\sim15$  ミクロンの範囲にある。次に 同じ方法で第 1 の層の上に誘電体の第 2 のおよび第 3 の 層がプリントされて加熱された。 3 つのプリントされて 焼結された誘電体層の組み合わせられた厚さは 40  $\sim$  5 0 ミクロンである。

【0138】発光しないことは、りん層との接続における両立性の問題に起因する。このことは、なまりニオブ酸塩が、本発明による単一のまたは第1の誘電体層として使用できないことを示す指標とすべきではない。

【0131】りん層が、公知の薄膜技術により誘電体層の上へ直接、被着された。詳細には、マンガンの1モルパーセントでドーピングした硫化銅の0.5ミクロンの厚さの層が、UHV Instruements Model 6000電子ビーム蒸着装置を用いて、誘電体層の上へ蒸着される。これらの層は蒸着装置の中で真空の下で加熱されて、約2分間、蒸着中に150℃の温度で維持される。

【0139】この実施例は、本発明により構成される2層の誘電体を示す。即ちなまりニオブ酸塩の第1誘電体層(第2実施例における様に)およびなまりジルコン酸20塩の第2誘電層である。所望の発光は達成された。

【0132】りん層が、酸化インジウムすずから成る透明な電気導体の0.5ミクロンの層でコーティングされる。この層は、公知の薄膜被着技術により被着される、詳細には電子ビーム蒸着装置を用いて400℃で真空の下で被着される。

【0140】実施例2におけると同様の素子が構成される。ただしゾルゲル工程を用いてなまりジルコン酸塩 (PZT)の層を、プリントされて加熱された誘電体層へ、りん層が被着される前に、被着させる付加的なステップを有する。ゾルは次のようにして準備された。酢酸が105℃で5分間、脱水される。酢酸なまり12グラムが、無色の溶液を形成する目的で、80°の脱水された酸の7m1の中へ溶融された。この溶液は冷却されて、5.54gのプロポキシ化ジルコニウムが、青黄色

【0133】次にラミネートは空気中で15分間、450℃で、酸化りんインジウム導体層を焼きなましする目的で、処理される。インジウムろう接点がITO層へ設けられる。この素子はシリコンシール材(Silicone Resin Clear Lacqver, cat. #419. M. G. Chemicals)によりシールされる。

ムが、無色の溶液を形成する目的で、80°の脱水された酸の7mlの中へ溶融された。この溶液は冷却されて、5.54gのプロポキシ化ジルコニウムが、青黄色の溶液を形成する目的で溶液中へ混合された。この溶液は60°~80°に5分間そのままにされ、その後に2.18gのインプロポキシ化チタンが撹拌しながら加えられた。生じた溶液は、残存している。溶質が溶融することを保証する目的で超音波バス中で撹拌された。次に1.75mlのエチレングリコール、プロパノール、水の4:2:1の溶液が、安定ゾルを形成する目的で加えられた。さらに多くのエチレングリコールがコーティングの前にスピンコーティングまたはディッピングのための所望の値へ粘性を調整する目的で、加えられた。準40 備された誘電体層は、回転コーティングされる、または

【0134】この案子は2つの電極の間にDC電圧を加えることにより試験される。この案子は、酸化インジウムすずへの接点の直接近傍の領域における誘電体層の電気的絶縁破壊を生ぜさせる電圧を加えて機能しなくなる 40か否かが観察される。

備された誘電体層は、回転コーティングされる、または ゾルでディッピングされた。回転コーティングの場合は ゾルが、3000rpmで水平面で回転中の第1誘電体 層上へ滴化された。ディッピングの場合は、より高い粘 性のゾルが使用された。ディッピング工程のために基板 が5cm/分の速度でゾルから引き上げられた。得られ たコーティングされたアセンブリは次に、ゾルをP2T へ変化させるために温度600℃で30分間、炉の中の

【0135】この素子の故障が、誘電層が、りん層のために必要とされる滑らかな表面を形成しないために生じたことが推定される。微小なひびが表面に観察されることもある。しかしこのことは市販の誘電体ペースト中の障害となる材料の存在に起因することもある。そのため、チタン酸塩バリウムは本発明による単一のまたは第1の誘電体層として使用できないことを示す指標ではない。

ンであった。PZT層の表面は、スクリーン印刷されて 50 焼結された第1誘電体層の表面よりも著しく滑らかであ

空気中で加熱された。 PZT層の厚さは約2~3ミクロ

【0136】 実施例2

ることが観察された。

【0141】P2T層の被着に続いて、りん層および透明層が実施例1におけるように被着される。

【0143】この実施例は、誘電体層の厚さにおける変 10 化は、動作電圧およびディスプレーの輝度に影響を与える。

【0144】ディスプレーは実施例3におけるように構成された。異なる点は、3つではなく2つだけのスクリーン印刷された誘電体層が被着された。第1誘電体層の厚さはそれに応じて25~30ミクロンへ低減された。

【0145】最小輝度のための閾値電圧は70V (実施例3において110燭光)が理論的な配慮から期待された。閾値を上回わる50Vにおける輝度も、35フットランベール (57燭光フットランベール、実施例3)へ 20低減された。

#### 【0146】実施例5

この実施例は、スルーホールを用いた駆動回路へ、EL ラミネートのローおよび行アドレス線を接続する有利な 実施例を示す。

【0147】アドレス指定可能なELディスプレーは、実施例3において示された層被着の同じシーケンスを用いて、構成される。基板は0.025インチの厚さの長方形のアルミナであった。このアルミナは、長さインチで幅2インチの寸法を有するCoors Ceramics (Grand Junction, Colorado, U.S.A)から入手された。基板は、図4に示されているパターンで、二酸化炭素レーザを用いて、直径0.006インチの貫通ホールがあけられた。基板は、全部のホールが明瞭であることを保証する目的で、検査された。孔は、レーザに面している側では直径が約0.008インチであることがわかった。大きい方の孔を有する側は、貫通ホールの中へ導電材料を挿入することを容易化する目的で、基板の裏側に選定された。

【0148】これに続いて、図5に示された回路パターンが、Cermalloy#4740銀プラチナペーストを用いて、325のメッシュステンレスステンレススチールスクリーンにより、プリントされた。このプリント工程中に基板は、図4に示されたのと同一のパターンで開けられた0.040インチの孔を有するマスタプレートと心合わせされ、さらに基板における質通ホールを通って導電ペースを引き出すためにマスタプレートの下に真空が加えられる(即ち基板の紙面側から見て、全面へ)。このステップは、基板における質通ホールの各々

38

を通る導電路と共に、図5の回路パターンを形成した。 真空の印加における一様性を保証する目的で、真空は、 基板がプリントされてからはじめて加えられる。この部 分は、質通ホールが充てんされることを保証する。

【0149】プリントに続いて、基板が、ペースト製造者により進められる温度プロフィルで、BTUモデルTFF142-790A24の中で加熱される。最高温度は850℃であった。

【0150】このステップに続いて、図7に示された回路補強パターンがプリントされて基板の回路裏側が加熱される(同じCermalloy導電ペーストを用いて)。このステップがこの回路パターンを、電気接続が実質的になされるべき所定の領域において、より厚くさせる。

【0151】次に列アドレス線および前側の列および行コネクタパッドは、基板の前側の上へスクリーン印刷された。線は基板の長さにわたり、図6に示されている列コネクタパッドへ延在した。図5に示されている行コネクタパッドがこの同じステップにおいてプリントされる。列アドレス線およびコネクタパッドは同じプリント条件および加熱条件を用いて、同じ導電ペースト(Cermalloy#4740)から形成された。基板は同じマスタプレート上で図4の貨通ホールにより位置定めされて、真空が、導電ペーストを貫通ホールを通してあれて、真空が、導電ペーストを貫通ホールを通してあれて、真空が、導電ペーストを貫通ホールを通してあたの裏側へ引き出す目的で下から加えられた。加熱された電極層の厚さは約8マイクロメータであった。1インチあたり52アドレス線が形成され、さらに全部のアドレス線の数は68であった。この部分は、貫通ホールが充てんされることを保証する目的で検査がなされた。

【0152】3層の誘電体ペースト(Cermalloy#IP9333)が、厚さが約50マイクロメータの 誘電体層を形成する目的で、実施例3に示されたよう に、プリントされて加熱された。

【0153】次に基板の回路裏側がシールされた。厚膜ガラスペースト(Heraeus IP9028, Heraeus-Cermalloy, Conshohocken, Pa製)が、図8に示されているパターンで250メッシュスクリーンを用いてスクリーンプリントされた。高電圧駆動チップへおよび他の駆動回路へ接続するためのコネクタパッドはカバーされなかった。次にガラスシール層が、製造者により勧められる温度プロフィルを用いて、BTUベルト炉の中で最高が700℃の温度で加熱された。

【0154】前述の加熱中に基板は、回路側の上のプリントされた材料と炉のベルトとの間の接触を回避する目的でセラミック材料部材の上で支持された。

【0155】ゾルゲル層は実施例3に述べたように実質的に浸液によって形成される。3つ又は4つのゾルゲル層が典型的には用いられる。例えば落球粘度計によって 50 測定されたほぼ100cPの粘度を有する混合からの1

40

10

30

0~25sec/inのプーリングレートでもって用い られる。浸漬層の間ではゾルゲルは110℃で10分間 乾燥される。バキュームチャックはラミネートのアクテ ィブ領域に亘って行われ、ゾルゲルは残りの領域を外し て水洗される。その後当該層はベルトファーネスにおい て約660℃で25分間焼結される。これによりゾルゲ ル全体の厚さが3~10μmの間で達成される。これは 1%のマンガンによってドーピングされ0.5~1.0 μmの厚さの硫化亜鉛が用いられた実施例3の燐光層に よって引き継がれる。

【0156】アドレスラインの行は実施例3において既 述したようにインジウムースズー酸化物の付着されたも のである(図9にパターンが示されている)。そこでは 1インチ毎に約52のアドレスラインの行が存在し全体 では256の行となる。ライン間の間隔は0.001イ ンチで、ライン幅は0.019インチである (cent er to center).

【0157】図10に示したパターンのように銀はシャ ドウマスクを通って行コネクタパッドへのアドレスライ ンの行の電気的接続形成のためにホールコンダクタを通 20 パターンを生ぜしめる。 って基板上に蒸着される。

【0158】ラミネートの見えている表面はシリコンシ ーラントによってシールされる。このシリコンシーラン トはディスプレイのフロント表面全体に亘って噴霧され ている。このシーラントにはM. G. ケミカルのシリコ ン樹脂クリアラッカ、Cat#419が用いられる。

【0159】ディスプレイ全体は、基板の後側に設けら れた回路上の列と行のパッドの対を交差して60H21 60 V の矩形波信号を供給するパルス発生器との接続に よって検査される。ディスプレイの各ピクセルは個別の 照明に基づくものであり、電圧を供給された場合の実施 例3において測定されたものと同じ一貫した強度であ る。機能的に障害のあるピクセルは17408の全ピク セル中から見つけだされる。

#### 【0160】実施例6

この実施例では本発明のELラミネートのインジウムー スズー酸化物ーアドレスラインがスクライビングされる レーザの有利な具体例が示されている。

【0161】アドレスで呼び出せるマトリックスディス プレイは以下のプロセスで用いられるセラミック基板上 40 に構成されている。このセラミック基板は厚さは0.0 25インチで、長さ6インチ、幅2インチのアルミナ矩 形体あり、Coors Ceramics (Grand

Junction, Colorado, U.S.A) から得られる。この基板にはカーボンディオキシードレ ーザを用いて直径0.006インチのホールが開けられ る。このパターンは図4に示されている。これらのホー ル全てが貫通していることを保証するためにその一部が 検査される。

【0162】このステップに続いて図5に示されている 50 これは0.5~1 $\mu$ mの間の厚さに亙って付着される。

回路パターンが325の網のステンレススクリーンによ ってプリントされる(このスクリーンにはCermal loy (Conshohocken Pnnsylva n i a, U. S. A) #4740シルバー白金ペースト が使用される)。プリント過程の間は、基板がマスター プレートに配列される。このマスタプレートはプリント 中に基板ホールへのバキュームの供給を容易にするため の基板と同じパタンで開けられた 0.04インチのホー ルを有している。バキュームは、一部の焼結の後にセラ ミック基板を通る伝導性パスの形成を容易にするために ホールを通してペーストを吸収する。この一部は大気中 にてBTUモデルTFF142-790A24ベルトフ ァーネスにおいてペースト製造元の推薦する温度デー タ、すなわち最大温度850℃でもって焼結される。こ のステップに続いて、図7に示されている回路補強パタ ーンがプリントされ基板後方の回路側に焼結される(こ こでも前述の "Cellmaloy" 導電性ペーストと 同じものが使用される)。このステップは、その後に電 気的接続のなされる確実な領域において比較的厚い回路

【0163】これに続いて、アドレスライン列のセット とコネクタパッドは基板の見えている前面にプリントさ れる。これらのラインは基板の全長に沿ってコネクタパ ッドまで延在している(図6)。コネクタパッドの行は このステップ(図6)において形成される。アドレスラ イン列とカラムコネクタパッド列は、同じプリント及び 焼結状態で用いられる同じシルバー白金ペーストから形 成される。基板は図4の貫通ホールを有している同じマ スタプレート上に位置している。バキュームは下方から 貫通ホールを通って基板の後側に向けて導電性ペースト を押し出すために供給される。焼結された電極層の厚さ は約8μmである。1インチ毎に52のアドレスライン が存在し、アドレスラインの総数は68である。

【0164】鉛・ニオブ酸塩誘電ペースト(Cerma 1 loy#IP9333) の次の3つの層はその後プリ ントされベルトファーナンスにおいて製造元で推奨され ている温度コンディション(最大温度850℃)でもっ てアドレスライン列の上部に焼結される。誘電層の結合 厚さは50μmである。

【0165】このステップに続いて、基板後方の回路側 は、そのパタンが図8に示されている実施例5に基づき シールされる。

【0166】次に3~10µmの厚さの鉛・ジルコン酸 塩・チタネート(P2T)の層は、なめらかな表面を形 成するために鉛・ニオブ酸塩誘電ペースト上に付着され る。実施例5に基づき使用され浸漬されるゾルゲル技術 が用いられている。薄膜状の燐光層は、電磁ビームを用 いた公知方式の蒸発によって付着される。 燐光層は1% のマンガンでもってドーピングされた硫酸亜鉛である。

【0167】次のステップは300nmの厚さの、イン ジウム・錫酸化物(ITO)の層を公知方式の電磁ビー ム蒸発の用いられた燐光層の上に付着させることであ る。

【0168】このITO層は、514.5nmの波長に 反転されるアルゴンイオンレーザの2watt CW (連続波長)を用いて256のアドレスラインへパター ン化される。ELラミネートは可動のX軸テーブル上に 取り付けられる。このX軸テーブルはラミネートをレー ザビームによってスクライビングされるラインに対して 10 垂直方向に動かす。レーザービームはラインをスクライ ピングするためにY軸方向に動かされる。レーザービー ムは12マクロメータのスポットに収束され、レーザー 出力は次のように調整される。すなわちインジウム・錫 酸化物とその下の燐光層とその下の結合された誘電層の 約10%とが、(約1.8W)のレーザービームの走査 された個所において取り除かれるように調整される。走 査速度は、それぞれ約40μm又は25μmのギャップ をおき、6~8 $\mu$ m又は3~4 $\mu$ mの深さでもってアド レスラインを設けるために約100mm/sec及び5 00mm/secに制御される。アドレスライン間(例 えばライン中央間)の間隔は約500μmである。基板 近傍のバキュームは材料の蒸発と除去を中止させる。透 過電極のパターンにおいては図9に示されているように 除去が一度に完全に行われる。全ディスプレイ上では約 50のアドレスラインの行が1インチ毎に存在し、全体 で256のカラムが存在する。

【0169】ITOカラムラインがスクライビングされ る前にフロント(行)コネクタパッドと最初のITOア パターン図に示されているようにシャドウマスクを通っ てシルバーからスクリーン印刷される。

【0170】レーザースクライビングの後では全ディス プレイのフロントビュー側が保護ポリマコーティング剤 を噴霧される(MGケミカル製シリコンリジンクリアラ ッカ, cat#419)。

【0171】ディスプレイはその後選択されたピクセル を横断する電圧を、パルス電力供給部との接続によって 供給されて検査される。このパルス電力供給部は160 Vのパルス電圧を64H2の繰返し周波数で供給する。 各ピクセルは前記実施例の単一ピクセル装置に相応する 光度でもって確実に点灯する。

【0172】当該実施例のアドレスラインによれば写真 平版技術形式によって得られるものよりも高度なものが 基本的に得られる。

【O173】実際に使用され得る装置の典型例ではIT Oアドレスラインの幅が180~205 μmで、ライン 間のギャップが65~80μmである。前記のことから 出発して本発明によれば25μmと40μmのギャップ

うな高い解決手段はディスプレイの全体に対して能動的 な領域の比較的高いレシオを考慮するものとなる。なぜ なら比較的小さなギャップで比較的ワイドなITOアド レスラインが使用され得るからである。

#### 【0174】実施例7

この実施例は本発明に従って誘電的に構成された2つの 層で表される。但しこの実施例では最初の誘電層は、前 記実施例3及び4で用いられたペーストよりも誘電率の 髙いペーストから形成される。

【0175】この装置は前記実施例の3から出発して構 成されているが、しかしながら第1の誘電層は鉛・ニオ ブ酸塩ペーストから形成される。このペーストは、ナン バ4210を用いて電気化学実験から高キャパシタンス ペーストKとして得られる。焼結されたペーストは約1 0000の誘電率を有する。最初の誘電層は約50μの 厚さを有する。PTZのゾルゲル層には実施例3に記載 されたように約5μの厚さが適用される。

【0176】この装置は最小輝度に対して91Vの閾値 電圧と150Vで50フートランベルトの光度でもって 機能する。

#### 【0177】実施例8

この実施例は誘電的に構成された2つの層で表される。 この場合第1の誘電層は鉛・ニオブ酸塩ペーストで形成 され、第2の誘電層は鉛・ランタン・ジルコン酸塩・チ タン酸塩ペースト (PLZT) から形成される。このP LZTは約1000の誘電率を有している。このPLZ Tにおいてはジルコニウム:チタニウム:ランタンの質 量比が52:32:16である。

【0178】実施例3から出発するものとして構成され ドレスラインとの間のシルバー・内部接続部が図10の 30 た装置は以下のようにして生成されたソルゲル層を有し

> 【0179】50mlの氷酢酸の中へ純度99.5%の 酢酸鉛120グラムを溶解する。この溶液は90℃まで 熟せられる。その後70℃まで冷やされる前に2分間こ の温度で保持される。次に55.4グラムのジルコニウ ムプロポキシードを加え、この溶液を80℃まで熱し、 この温度で1分間保持する。70℃まで冷された後にチ タニウム・イソプロポキシードが21.8グラム加えら れる。次に、硝酸ランタン11. 4グラムを20mlの 氷酢酸で溶解して、前記溶液に加える。最後にこの溶液 40 を安定化させ、粘度を適合値へ調整するために、エチレ ングリコール10ml, プロパン-2ol 5ml, 脱 塩水2.5mlがそれぞれ加えられる。

【0180】PLZTゾルゲル層は前記実施例3に記載 されたものと類似の手段による浸漬によって形成された 最初の誘電層に用いられる。浸漬された部分はPL2T に対する第2の層に転化させるために600℃でもって 焼結される。PLZTの4つの層が、燐光層の付着のた めの十分に滑らかな表面を作成するために前記のような がレーザの走査速度に依存して生ぜしめられる。このよ 50 連続的な浸潤と焼結によって使用される。全体で5μの 厚さが得られる。

【0181】この装置は75Vの閾値電圧と150Vで37フートランベルトの光度でもって機能する。

【0182】これまでに言及してきた全ての記載は、本発明に関係する熟練を要する形式の特殊技術レベルを示すものである。全ての記載はここにおいて関係により言及されるべく各個別の記載が詳細かつ個別に示されたものであるのと同じ範囲の言及でもって具体化されたものである

【0183】本明細審において用いられた専門的用語及び表現は説明のための用語として用いられたものであって限定を加えるためのものではない。またこのような専門用語及び表現の使用に関してこれまでに図示及び説明したきた特徴に相応するものを除外するほどに強調されたものでもない。あくまでも本発明の範囲は請求項において明示され限定されているものであることを述べておく

#### [0184]

【発明の効果】本発明により、改善されたエレクトロルミネセンスラミネート誘電層構造体およびこの誘電層構 20 造体を生成する方法が提供される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の2つの誘電層を含むラミネート構造体 の横断面図である。

【図2】図1のラミネート構造体の平面図である。

【図3】列電極アドレス線路および行電極アドレス線路 を電圧駆動回路の電圧駆動コンポーネントと接続する有 利な実施例を示す、行電極に沿って切断されたラミネー ト構造体の横断面図である。

【図4】アドレス線路と駆動回路の電圧駆動コンポーネントとを電気接続するためのスルーホールの有利なパターンの設けられた背面基板の平面図である。

【図5】背面基板の背面側に印刷された有利な駆動回路 パターンの平面図である。

【図6】背面基板の前面側に印刷された列電極および行 経路の平面図である。

70 【図7】図5の駆動回路パターン上に有利に印刷された 回路経路補強パターンの平面図である。

【図8】図5および図7の駆動回路パターンと回路経路 補強パターン上に有利に印刷されたシーリングガラスパ ターンの平面図である。

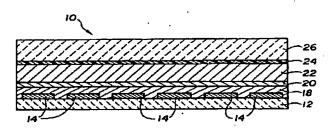
【図9】行電極線路パターンの平面図である。

【図10】図9の行線路と図6の行経路との間に印刷された電気接続の平面図である。

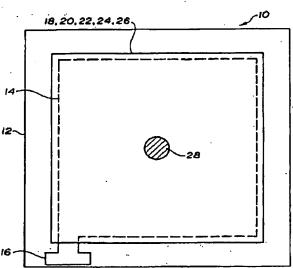
#### 【符号の説明】

- 10 誘電層構造体
- 12 基板
  - 14 背面電極
  - 18 第1の誘電層
  - 20 第2の誘電層
  - 22 燐光層
  - 24 前面電極
  - 26 シール層

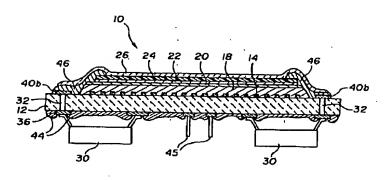
【図1】



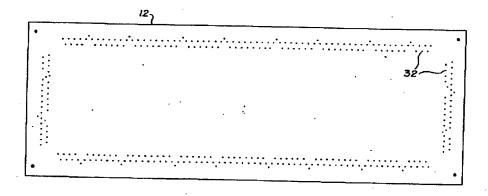
【図2】



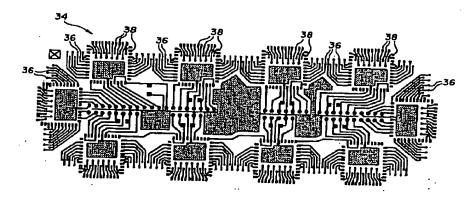




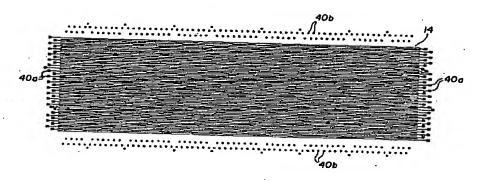
[図4]



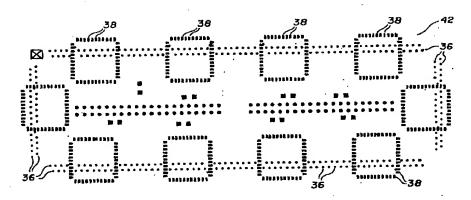
【図5】



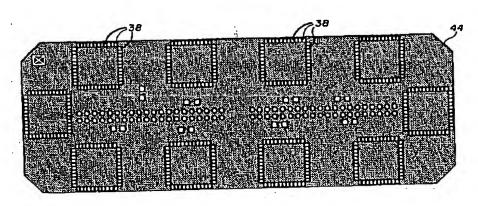
【図6】



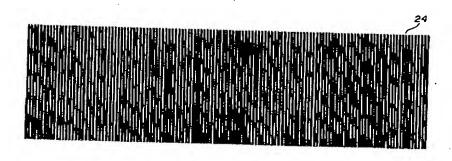
【図7】



【図8】



【図9】



【図10】

フロントページの続き

(72)発明者 ケン コック フー カナダ国 アルバータ エドモントン 10032-113 ストリート 10 (72)発明者 フィリップ ベイリー カナダ国 アルバータ エドモントン 10011-89 アヴェニュー 102